(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-228874 (P2004-228874A)

(43) 公開日 平成16年8月12日(2004.8.12)

(51) Int.C1. ⁷		FΙ			テーマコード (参考)
HO4N	5/335	HO4N	5/335	E	5CO24
HO4N	1/028	HO4N	1/028	Α	5CO51

審査請求 有 請求項の数 7 〇L (全 35 頁)

			THAT IT HAT SALE OF ALL OF SALE
(21) 出願番号	特願2003-13606 (P2003-13606)	(71) 出願人	000002369
(22) 出願日	平成15年1月22日 (2003.1.22)		セイコーエプソン株式会社
			東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(74) 代理人	100095728
			弁理士 上柳 雅誉
		(74) 代理人	100107076
			弁理士 藤綱 英吉
		(74) 代理人	100107261
			弁理士 須澤 修
		(72) 発明者	金井 正博
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
			ーエプソン株 式会
			社内
		Fターム (参	考) 5C024 CX51 GX03 GY01 GY31 GZ04
			HX55 JX21
			最終頁に続く

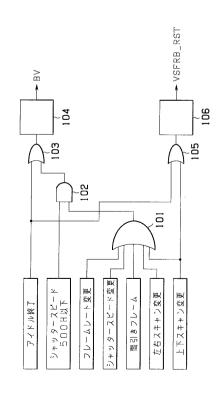
(54) 【発明の名称】画像処理装置、画像処理方法及び固体撮像装置

(57)【要約】

【課題】適切な画像出力を、遅れることなく得るための 画像処理装置、画像処理方法及び固体撮像装置を提供す る。

【解決手段】マトリックスの各ラインに垂直で、かつ指定された方向に複数のラインをスキャンすることによって、受光した光に応じて前記フォトダイオードにキャリアを生じさせる蓄積状態において蓄積されたキャリアに応じた信号を読み出すラインを選択するための読み出しライン用シフトレジスタと、固体撮像素子内に残留するキャリアを固体撮像素子から排出するためのクリアラインを選択するためのクリアライン用シフトレジスタと、マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、読み出しライン用シフトレジスタリセット信号を出力する読み出しライン用シフトレジスタリセット信号出力回路とを有する。

【選択図】 図17



【特許請求の範囲】

【請求項1】

フォトダイオードと光信号検出用のトランジスタとを備えた単位画素が複数配列されたマ トリックス型の固体撮像素子から画像信号を読み出す画像処理装置において、

前記マトリックスの各ラインに対して、受光した光に応じて前記フォトダイオードにキャリアを生じさせる蓄積状態において蓄積されたキャリアに応じた信号を読み出すラインを選択するための読み出しライン用シフトレジスタと、

前記固体撮像素子内に残留する前記キャリアを前記固体撮像素子から排出するためのクリアラインを選択するためのクリアライン用シフトレジスタと、

前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用シフトレジスタヘリセット信号を出力する読み出しライン用シフトレジスタリセット信号 出力回路と、

を有することを特徴とする画像処理装置。

【請求項2】

さらに、前記読み出しラインと前記クリアラインの間のライン数が前記マトリックスのライン数以下において、前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用シフトレジスタへ読み出しライン選択信号を出力するための読み出しライン用シフトデータと出力回路を有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。

【請求項3】

前記読み出しライン用シフトデータ出力回路は、さらに、前記読み出しラインと前記クリアラインの間の前記ライン数が前記マトリックスのライン数を超えた場合、前記読み出し ライン用シフトレジスタへ読み出し前記ライン選択信号を出力するための前記読み出しライン用シフトデータの出力を禁止することを特徴とする請求項2に記載の画像処理装置。

【請求項4】

さらに、前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記クリアライン用シフトレジスタヘリセット信号を出力するクリアライン用シフトレジスタリセット信号出力回路を有することを特徴とする請求項 1、請求項 2 又は請求項 3 に記載の画像処理装置。

【請求項5】

さらに、フレームレイトに従って間引きフレームが発生したとき、前記読み出しライン用シフトデータ出力回路は、前記読み出しライン選択信号を出力することを特徴とする請求項 1、請求項 2、請求項 3 又は請求項 4 に記載の画像処理装置。

【請求項6】

フォトダイオードと光信号検出用のトランジスタとを備えた単位画素が複数配列されたマトリックス型の固体撮像素子から画像信号を読み出す画像処理方法において、

前記マトリックスの各ラインに対して、受光した光に応じて前記フォトダイオードにキャリアを生じさせる蓄積状態において蓄積されたキャリアに応じた信号を読み出すラインを選択するための読み出しライン用シフトレジスタと、

前記固体撮像素子内に残留する前記キャリアを前記固体撮像素子から排出するためのクリ アラインを選択するためのクリアライン用シフトレジスタと、

前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用 シフトレジスタへリセット信号を出力することを特徴とする画像処理方法。

【請求項7】

フォトダイオードと光信号検出用のトランジスタとを備えた単位画素が複数配列されたマ トリックス型の固体撮像素子と、

前記マトリックスの各ラインに対して、受光した光に応じて前記フォトダイオードにキャリアを生じさせる蓄積状態において蓄積されたキャリアに応じた信号を読み出すラインを選択するための読み出しライン用シフトレジスタと、

20

10

30

50

20

30

40

50

前記固体撮像素子内に残留する前記キャリアを前記固体撮像素子から排出するためのクリアラインを選択するためのクリアライン用シフトレジスタと、

前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用シフトレジスタへリセット信号を出力する読み出しライン用シフトレジスタリセット信号 出力回路と.

を有することを特徴とする固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像処理装置、画像処理方法及び固体撮像装置に関する。特に、マトリックス型の固体撮像素子から画像信号を読み出す画像処理装置、画像処理方法及び固体撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

半導体イメージセンサは、種々の画像入力装置に利用されている。最近、その中で、閾値電圧変調方式のMOS型固体撮像素子が、CCD(電荷結合素子)の高性能画質とCMOSの低消費電力とを兼ね備え、さらに高密度化および低コスト化を実現するものとして注目されている。

閾値電圧変調方式のMOS型固体撮像素子の技術は、例えば、特開平11-195778号公報に開示されている。閾値電圧変調方式のMOS型固体撮像素子では、初期化、蓄積及び読出の3つの状態を繰り返すことによって、各画素のキャリアポケットに蓄積された光発生電荷に基づく画像信号が取り出される。初期化状態の期間は、残留電荷をキャリアポケット内から排出する期間である。蓄積状態の期間は、センサセルに電荷を蓄積する期間である。読出状態の期間は、蓄積された電荷量を電圧変調して読み出す期間である。

[0003]

【特許文献1】

特開平11-19578号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

ところが、撮像条件の一つであるスキャン方向の変更があった場合、適切な画像出力を、遅れることなく得るための読み出し及びクリアのラインの制御については、上述した特開平11-195778号には、特に言及されていない。

[0005]

【課題を解決するための手段】

そこで、本発明は、適切な画像出力を、遅れることなく得るための画像処理装置、画像処理方法及び固体撮像装置を提供することを目的とする。

本発明の画像処理装置は、フォトダイオードと光信号検出用のトランジスタとを備えた単位画素が複数配列されたマトリックス型の固体撮像素子から画像信号を読み出す画像処理装置において、前記マトリックスの各ラインに対して、受光した光に応じて前記フォトダイオードにキャリアを生じさせる蓄積状態において蓄積されたキャリアに応じた信号を読み出すラインを選択するための読み出しライン用シフトレジスタと、前記固体撮像素子内に残留する前記キャリアを前記固体撮像素子から排出するためのクリアラインを選択するためのクリアライン用シフトレジスタと、前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用シフトレジスタへリセット信号を出力する読み出しライン用シフトレジスタリセット信号出力回路とを有する。

[0006]

本発明の画像処理方法は、フォトダイオードと光信号検出用のトランジスタとを備えた単位画素が複数配列されたマトリックス型の固体撮像素子から画像信号を読み出す画像処理方法において、前記マトリックスの各ラインに対して、受光した光に応じて前記フォトダイオードにキャリアを生じさせる蓄積状態において蓄積されたキャリアに応じた信号を読

み出すラインを選択するための読み出しライン用シフトレジスタと、前記固体撮像素子内に残留する前記キャリアを前記固体撮像素子から排出するためのクリアラインを選択するためのクリアライン用シフトレジスタとを設け、前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用シフトレジスタへリセット信号を出力する。

[0007]

本発明の固体撮像装置は、フォトダイオードと光信号検出用のトランジスタとを備えた単位画素が複数配列されたマトリックス型の固体撮像素子と、前記マトリックスの各ラインに対して、受光した光に応じて前記フォトダイオードにキャリアを生じさせる蓄積状態において蓄積されたキャリアに応じた信号を読み出すラインを選択するための読み出しライン用シフトレジスタと、前記固体撮像素子内に残留する前記キャリアを前記固体撮像素子から排出するためのクリアラインを選択するためのクリアライン用シフトレジスタと、前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用シフトレジスタへリセット信号を出力する読み出しライン用シフトレジスタリセット信号出力回路とを有する。

このような構成によれば、適切な画像出力を、遅れることなく得ることができる。

[0008]

また、本発明の画像処理装置において、さらに、前記読み出しラインと前記クリアラインの間のライン数が前記マトリックスのライン数以下において、前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記読み出しライン用シフトレジスタへ読み出しライン選択信号を出力するための読み出しライン用シフトデータを出力する読み出しライン用シフトデータ出力回路を有することが望ましい。

このような構成によれば、前記読み出しラインと前記クリアラインの間のライン数が前記マトリックスのライン数以下においても、適切な画像を得ることができる。

[0009]

また、本発明の画像処理装置において、前記読み出しライン用シフトデータ出力回路は、 さらに、前記読み出しラインと前記クリアラインの間の前記ライン数が前記マトリックス のライン数を超えた場合、前記読み出しライン用シフトレジスタへ読み出し前記ライン選 択信号を出力するための前記読み出しライン用シフトデータの出力を禁止することが望ま しい。

このような構成によれば、前記読み出しラインと前記クリアラインの間の前記ライン数が 前記マトリックスのライン数を超えた場合でも、適切な画像を得ることができる。

[0010]

また、本発明の画像処理装置において、さらに、前記マトリックスのラインをスキャンする方向が変更された場合、前記クリアライン用シフトレジスタへリセット信号を出力するクリアライン用シフトレジスタリセット信号出力回路を有することが望ましい。

このような構成によれば、次のサイクル中にクリアラインの選択信号が複数存在することがなくなり、一つの画像中に画質が異なる部分が生じてしまうことがなくなる。

[0011]

また、本発明の画像処理装において、さらに、フレームレイトに従って間引きフレームが発生したとき、前記読み出しライン用シフトデータ出力回路は、前記読み出しライン選択信号を出力することが望ましい。

このような構成によれば、フレームレイトが低くなっても、適切な画像出力を得ることができる。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

まず、図1に基づき、本実施の形態に係わる画像処理装置の構成を説明する。

図 1 は、固体撮像装置であるイメージセンサLSI(大規模集積回路) 1 と、信号処理装置である信号処理LSI2からなる画像処理装置の構成を示すブロック構成図である。イ

30

20

40

メ ー ジ セ ン サ L S I 1 は 、 2 次 元 の 固 体 撮 像 装 置 で あ り 、 光 学 像 を 光 電 変 換 し て 、 光 学 像 に基づく画素信号を信号処理LSI2へ供給する。信号処理LSI2は、受信した各画素 信号に対して予め決められた信号処理を施して、画像信号を出力する。

[0013]

イメージセンサLSI1は、センサセルアレイ3と、クリアライン用シフトレジスタ4と 、 読 み 出 し ラ イ ン 用 シ フ ト レ ジ ス タ 5 と 、 垂 直 ド ラ イ ブ 回 路 6 と 、 昇 圧 回 路 7 と 、 レ ギ ュ レータ8と、蓄積信号用ラインメモリ9と、オフセット信号用ラインメモリ10と、水平 シフトレジスタ11と、出力アンプ12と、タイミングジェネレータ13とを含む。タイ ミングジェネレータ13は、レジスタ14と3線シリアルインターフェース15を含む。

イメージセンサLSI1のセンサセルアレイ3は、例えば、特開平11-195778号 に記載されたような閾値変調型の固体撮像素子である。タイミングジェネレータ13から 、 各 回 路 へ 各 種 制 御 信 号 が 供 給 さ れ 、 そ の 各 種 制 御 信 号 に 基 づ い て 、 セ ン サ セ ル ア レ イ 3 は、各セルの受光した光量に応じた画素信号を出力する。また、センサセルアレイ3は、 例 え ば 、 6 4 0 × 4 8 0 の セ ル と 、 オ プ テ ィ カ ル ブ ラ ッ ク (O B) の た め の 領 域 (O B 領 域)を含む。 O B 領域を含めると、センサアレイ 3 は例えば 7 1 2 × 5 0 0 のセルで構成 される。そして、イメージセンサLSI1は、受光光量に応じた信号成分の電圧出力信号 VOUTSと、オフセット成分に応じた電圧出力信号VOUTNの2つの出力信号を、信 号処理LSI2へ供給する。

[0015]

垂直ドライブ回路6は、読み出しラインとクリアラインを選択するための回路である。 み出しライン用シフトレジスタ5とクリアライン用シフトレジスタ4は、それぞれ読み出 しラインとクリアラインを指定するための回路である。

レギュレータ8は、イメージセンサLSI1内で必要とされる各種電圧を生成するための 電圧生成回路である。昇圧回路7は、後述するように、センサセルアレイ3に対して必要 な電圧を与えるために、レギュレータ8から供給された電圧を昇圧するための回路である 。なお、イメージセンサLSI1のより詳細な説明は、図2を用いて後述する。

[0016]

信号処理LSI2は、差分アンプ回路16と、オプティカルブラック(以下、OBと略す 。) クランプ回路 1 7 と、プログラマブルゲインアンプ回路 (P G A) 1 8 と、アナログ ディジタル変換回路(ADC)19と、OB制御ロジック回路20と、輝度制御ロジック 回路21と、輝度測光ロジック回路22と、レジスタ23と、イメージプロセッサ24と 、 シーケンサ 2 5 と、タイミングジェネレータ 2 6 とを含む。レジスタ 2 3 は、シャッタ -スピードデータ等のデータがストアされる。

[0017]

イメージセンサLSI1からのVOUTSとVOUTNの 2 つのアナログ信号は、差分ア ンプ回路16に入力される。信号処理LSI2の差分アンプ回路16は、信号成分の電圧 値 と オ フ セ ッ ト 成 分 と の 電 圧 値 の 差 を 取 っ て 増 幅 し 、 O B ク ラ ン プ 回 路 1 7 へ そ の 差 分 電 圧を出力する。

O B クランプ回路 1 7 は、入力された画素信号の黒レベルを黒色の適切なレベルに設定す るための回路である。センサセルアレイ3内の予め決められた数画素分のセル、すなわち O B 領域は、遮光板等によって遮光されており、その遮光されたセルの信号レベルに基づ いて、有効画素領域の画素信号に対する適切な黒色レベル調整が行われる。

[0018]

PGA18は、例えば1デシベル単位でゲインを調整するための増幅器である。PGA1 8によって増幅された信号は、ADC19へ供給される。ADC19はPGA18の出力 をディジタル信号に変換する。

OB領域の画素については、その画素の輝度データが、ADC19からディジタル信号と して O B 制 御 口 ジック 回 路 2 0 に 供 給 され る。 O B 制 御 口 ジック 回 路 2 0 は 、 タイ ミン グ ジェネレータ26からの制御信号に基づいて、ADC19からの信号を入力し、黒レベル 10

20

30

40

20

30

40

50

の調整をするためにOBクランプ回路17へ制御信号を出力する。

[0019]

同様に、輝度測光ロジック回路 2 2 は、例えば、A D C 1 9 から供給される 1 フレーム内の全ての緑(G)の画素のデータに基づいて、輝度を測定し、輝度データを輝度制御ロジック 2 1 に供給する。

輝度制御ロジック回路 2 1 は、輝度測光ロジック回路 2 2 から供給される輝度データに基づいて、 P G A 1 8 ヘゲイン制御信号を供給することによって、画像の明るさの調整を行う。さらに、輝度制御ロジック回路 2 1 は、レジスタ 2 3 ヘシャッタースピードのデータを書き込む。

[0020]

なお、レジスタ14とレジスタ23は、互いに同じデータをストアするようになっているので、一方のレジスタの内容が変更されると、3線シリアルインターフェース15を介して、他方のレジスタの内容も変更される。よって、シャッタースピードのデータが、信号処理LSI2内のレジスタ23に書き込まれると、さらに、そのデータは、3線シリアルインターフェース15を介して、イメージセンサLSI1内のレジスタ14に転送されて書き込まれる。イメージセンサLSI1では、シャッタースピードのデータに基づいて、フォーカルプレーンシャッターの設定が行われる。フォーカルプレーンシャッターの機能については後述する。

[0021]

例えば、イメージセンサLSI1側では、シャッタースピードのデータに基づいて、フォーカルプレーンの読み出しラインとクリアラインの幅dlを制御する。画像が明るい場合のように、露光時間を短くする場合には、その幅dlを狭めるように、すなわち読み出しラインとクリアライン間のライン数を小さくするように、制御が行われる。また、画像が暗い場合のように、露光時間を長くする場合には、その幅dlを広げるように、すなわち読み出しラインとクリアライン間のライン数を大きくするように、制御が行われる。さらに、シャッタースピードの制御だけでは露光が適切でないときは、輝度制御ロジック回路21は、信号ゲインを調整することによって、信号量を適切になるように制御する。

[0022]

信号処理LSI2には、システムクロック信号CLKINが供給され、そのシステムクロック信号CLKINに基づいて、タイミングジェネレータ26は、種々のタイミング信号を生成する。信号処理LSI2は、種々のタイミング信号の中から各種同期信号を、イメージセンサLSI1に供給する。同期信号としては、センサ駆動クロック信号SCLK、垂直同期信号VSYNC、水平同期信号HSYNCがある。イメージセンサLSI1はこれらの同期信号に基づいて同期を取って、画像信号を信号処理LSI2へ供給する。従って、SCLK、VSYNC、HSYNCの各信号は、システムクロック信号CLKINに依存する。

[0023]

信号処理 L S I 2 のレジスタ 2 3 には、各種パラメータ、例えば、全体に、あるいは部分的に明るくするためのパラメータ等が、 I 2 C - B u s (アイスクエアシーバス) I / F を介して入力され、ストアされる。

信号処理LSI2において、イメージプロセッサ24は、RGBの信号に基づいて画像を 生成するための回路であり、シーケンサ25は、イメージプロセッサ24を駆動するため の回路である。

[0024]

イメージセンサLSI1のタイミングジェネレータ13には、さらにクロック指定信号CLK_SELが、入力されるようになっている。CLK_SELは、イメージセンサLSI1が動作されるクロック周波数の指定を明示的に、イメージセンサLSI1に知らせるすなわちイメージセンサLSI1にクロックの高低指示を制御信号として入力する、ための信号である。CLK_SELに基づいて、タイミングジェネレータ13が各種制御信号の出力タイミングを変更する。さらに、タイミングジェネレータ13には、スタンバイ信

20

30

50

号STANDBYが入力される。

[0025]

イメージセンサLSI1のレジスタ14には、シャッタースピード、レギュレータの電圧 設定、スキャン方向の指定、等のデータが 3 線シリアルインターフェース 1 5 を介して入 力され、ストアされる。

また、イメージセンサLSI1は、一つの制御信号として有効信号VALIDを信号処理LSI2のタイミングジェネレータ26へ供給する。VALIDは、イメージセンサLSI1から有効な画像データが出力されていることを示す信号である。この信号がアクティブなときは、有効な画像データがイメージセンサLSI1から出力されているので、そのデータを測光等に使用できることを、信号処理LSI2は知ることができる。

[0026]

次に、イメージセンサLSI1の構成について説明する。図2は、イメージセンサLSI 1の構成を示す回路図である。

センサセルアレイ3は、m×n(m行n列)個のセルS11~Smnからなるマトリックスの固体撮像素子である。一つのセルが、一つの単位画素に対応する。各単位画素に対応する。各単位画素に対応するを単位画素に対応するを単位画素に対応するを単位画素に対応するを単位画素に対応がウェルのまた。カードアロSと、光信号検出用絶縁ゲート型電界効果型トランジスタアロエル領域からなり、入射光に応じてホール(正孔)がウエル領域内に生じる。そのウエル領域からなり、入射光に応じてホール(正孔)がウエル領域内に生じる。そのウエル領域と、光信号検出用MOSトランジスタアロTrと共有されており、光信号検出用MOSトランジスタアロTrのドレイン拡散領域は、ウェス拡散領域と、光信号検出用MOSトランジスタアロTrのドレイン拡散領域は、ウェス拡散領域の表層に一体的に形成されている。リング状のゲート電極の中心部にソース拡散領域が形成されている。ゲート電極下のウエル領域内であって、ソース拡散領域の周辺の周域が形成されている。ゲート電極下のウエル領域内であって、ソース拡散領域の周辺のに、ソース拡散領域を取り囲むようにキャリアポケットが形成されている。センサ構造の詳細は、特開平11・195778号公報に記載されている。

[0027]

センサセルアレイ3から光量に応じた信号を得るために、蓄積、読み出し及びクリアの3 状態のそれぞれにおいて、各セルのゲート、ソース及びドレインに、所定のバイアス電圧 を印加することによって、光量に応じた信号を得ることができる。簡単に言えば、蓄積状 態 の と き 、 フ ォ ト ダ イ オ ー ド P D S に 入 射 し た 光 量 に 応 じ て 生 じ た ホ ー ル を キ ャ リ ア ポ ケ ットに蓄積させる。読み出し状態のとき、蓄積されたホールに基づいて信号電圧を読み出 す。読み出された信号電圧は、ゲート電圧と、受光量に応じて変化した閾値との差に応じ た 電 圧 信 号 で あ る 。 ク リ ア 状 態 の と き 、 昇 圧 回 路 7 に よ っ て 光 信 号 検 出 用 M O S ト ラ ン ジ スタPDTrのソース電圧を所定の値に昇圧するとともに、リングゲート、ソース間のカ ップリング容量により、ゲート電圧も所定の値に昇圧され、光信号検出用MOSトランジ ス タ P D T r が タ ー ン オン し 、 リ ン グ ゲ ー ト 下 に チ ャ ネ ル が 形 成 さ れ る 。 従 っ て 、 ド レ イ ン電圧はソース電圧とほぼ等しい値(ドレイン電圧VD=VG-Vthでゲート電圧VG がソース電圧より十分高い場合)となり、ソース、チャネル、ドレイン下の空乏層が広が ることによって、蓄積されたホールは基板方向へ掃き出され、ホール等の残留電荷を排出 する。クリア後、ノイズ成分を含むオフセット電圧を読み出し、信号電圧とオフセット電 圧との差分をとることによって、画像信号を得ることができる。各セルについて、上述し た動作を行い、画像信号を得ることによって、2次元の画像信号を得ることができる。バ イアス条件、すなわち各状態における各セルのゲート、ソース及びドレインのバイアス電 圧については、後述する。

[0028]

クリアライン用シフトレジスタ 4 は、クリアするラインを指定するための回路である。クリアライン用シフトレジスタ 4 には、クリアライン用シフトデータ A V 、クリアライン用シフトクロック信号 V C L K _ A S R 、クリアライン用シフトレジスタリセット信号 V S F R A _ R S T が入力される。クリアライン用シフトレジスタ 4 は、マトリックス状のセ

ンサセルアレイ 3 の中の、 蓄積電荷をクリアするラインを選択するクリアライン選択信号 VSA1ないしVSAmを出力する。

[0029]

読み出しライン用シフトレジスタ5は、読み出しラインを指定するための回路である。読み出しライン用シフトレジスタ5には、読み出しライン用シフトデータBV、読み出しライン用シフトクロック信号VCLK_BSR、読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTが入力される。読み出しライン用シフトレジスタ5は、マトリックス状のセンサセルアレイ3の中の、信号電圧を読み出すラインを選択する読み出しライン選択信号VSB1ないしVSBmを出力する。

[0030]

シャッタースピードのデータに基づいて決められた出力タイミングでクリアライン用シフトデータAVと読み出しライン用シフトデータBVが与えられることによって、クリアライン用シフトレジスタ4と読み出しライン用シフトレジスタ5は、順番に選択信号を出力する。すなわち、読み出しライン用シフトデータBVは、垂直同期信号VSYNCに対して予め決められたタイミングで生成されるが、読み出しライン用シフトデータBVとクリアライン用シフトデータAVとの位相関係はシャッタースピードによって決定され、その位相関係を保った状態で、クリアライン用シフトレジスタ4と読み出しライン用シフトレジスタ5は、順番に選択信号を出力する。なお、後述するように、1フレーム中に読み出しラインとクリアラインが存在するときは、センサアレイの中の2つのラインが指定され、選択される。

[0031]

垂直ドライブ回路6は、ライン毎に、2つのAND回路31、32と、OR回路33と、バッファ回路34と、ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1i(iは、1からmのいずれかである。以下、同じ。)とを含む。一つのAND回路31は、クリアライン選択信号VSAiとクリアライン選択イネーブル信号CLSとを入力とする。他方のAND回路32は、読み出しライン選択信号VSBiと、信号読み出し、クリア、ノイズ読み出しの3つの動作の読み出しライン選択イネーブル信号VSMとを入力とする。OR回路33は、各AND回路31、32の出力信号と蓄積時全ライン選択信号VGUPとを入力とする。バッファ回路34は、そのOR回路33からの出力信号を入力とする。各バッファ回路34の出力信号は、ライン選択信号VSCiとして、ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iへ供給される。

[0032]

ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iには、ライン選択信号VSCiに加えて、蓄積イネーブル信号SDI、読み出しイネーブル信号SDR2及びクリアパルス信号CLが入力される。ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iは、対応するラインの全セルのゲート及びドレインに印加するための電圧を選択して出力する。すなわち、ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iは、各ラインの各セルに、ドレイン電圧VPDiと、ゲート電圧VPGiを供給する。このドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iの詳細は後述する。

[0033]

ソース電圧供給回路 V C 2 h (h は、 1 から n のいずれか。以下、同じ。)が、マトリックスの列毎に、設けられている。ソース電圧供給回路 V C 2 h には、クリアパルス信号 C L 及びクリア前ゲートプリセット信号 P R が入力される。ソース電圧供給回路 V C 2 h は、各列の全セルのソースに、ソース電圧 V P S h を供給する。このソース電圧供給回路 V C 2 h の詳細は後述する。

[0034]

各列に対応するソース線が蓄積信号用ラインメモリ9とオフセット信号用ラインメモリ10とに、ラインメモリデータロード信号 LOADが入力されるスイッチSW1hを介して接続されている。

蓄積信号用ラインメモリ9は、各列に対応した選択回路HShを含む。各選択回路HShは、電荷蓄積用コンデンサC2と、読み込み用スイッチSW21と、リセット用スイッチ

10

20

30

40

SW22と、出力用スイッチSW23とを含む。

[0035]

オフセット信号用ラインメモリ10は、各列に対応した選択回路HNhを含む。各選択回路HNhは、電荷蓄積用コンデンサC3と、読み込み用スイッチSW31と、リセット用スイッチSW32と、出力用スイッチSW33とを含む。

蓄積信号用ラインメモリ9への蓄積信号用ラインメモリデータロード信号LOADSが入力されると、SW21がオンとなって、各ソース線から光量に応じた電圧がコンデンサC2に与えられ、コンデンサC2にその電圧に応じた電荷が蓄積される。読み出しライン用シフトレジスタ5によって選択された1ライン分の画素信号が、LOADSに応じて、蓄積信号用ラインメモリ9にストアされる。

[0036]

蓄積信号用ラインメモリ9への蓄積信号用ラインメモリリセット信号RESSは、信号読み出し直前にコンデンサC2を予め決められた電圧VMPRにするための信号である。電圧VMPRは、リセット用スイッチSW22をオンにすることによって、レギュレータ8で生成された電源35からコンデンサC2に供給される。

[0037]

そして、水平シフトレジスタ11からの選択信号HSCANhによって、蓄積信号用ラインメモリ9の各選択回路HShのスイッチSW23は順番にオンされていく。オンされたSW23は、コンデンサC2に蓄積された電荷に応じた電圧を出力するので、読み出しライン用シフトレジスタ5で選択された1ラインの画素信号が、VOUTS信号として順番に出力アンプ36を介して出力される。

[0038]

オフセット信号用ラインメモリ10へのオフセット成分蓄積信号用ラインメモリデータロード信号LOADNが入力されると、スイッチSW31がオンとなって、各ソース線からオフセット成分に応じた電圧が与えられ、コンデンサC3にその電圧に応じた電荷が蓄積される。読み出しライン用シフトレジスタ5によって選択された1ライン分の画素信号が、オフセット成分蓄積信号用ラインメモリデータロード信号LOADNに応じて、オフセット信号用ラインメモリ10にストアされる。オフセット信号用ラインメモリ10へのオフセット信号用ラインメモリリセット信号RESNは、オフセット成分の信号の読み出し直前にコンデンサC3を予め決められた電圧VMPRにするための信号である。電圧VMPRは、リセット用スイッチSW32をオンにすることによって、レギュレータ8で生成された電源37からコンデンサC3に供給される。

[0039]

そして、水平シフトレジスタ11は、オフセット信号用ラインメモリ10の各選択回路HNhのスイッチSW33を順番にオンしていく。オンされたSW33は、コンデンサC3に蓄積された電荷に応じた電圧を出力させるので、読み出しライン用シフトレジスタ5で選択された1ラインの画素信号のオフセット成分の信号が、VOUTN信号として順番に出力アンプ38を介して出力される。イメージセンサLSI1からのVOUTSとVOUTNの2つの電圧アナログ信号は、信号処理LSI2の差分アンプ回路16に入力される

[0 0 4 0]

図3は図2のドレイン・ゲート電圧供給回路VC11ないしVC1mの構成を示す回路図である。ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iは、NAND回路、インバータ回路、トランジスタを含み、各種入力信号に応じて、ドレイン電圧VPDとゲート電圧VPGを出力する。

各ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iには、クリアパルス信号CL、蓄積イネーブル信号SDI及び読み出しイネーブル信号SDR2が入力され、供給されているVCCSGHR、VCCSGHI、VCCSDR及びVCCSDIの電圧を用いて、後述する図5のバイアス電圧を発生し、各センサセルのドレインとゲートに与える。

[0041]

40

30

10

20

20

30

40

センサセルアレイ 3 は、次のような状態を有する。これらの各状態は、詳細には、"蓄積"、"リセット(S)"、"変調(S)"、"プリセット"、"クリア"、"リセット(N)"及び"変調(N)"の各状態を含み、これらの各状態の繰返しによって、光学像を電気信号に変換して出力する。蓄積イネーブル信号 SDIは、ローアクティブの信号であり、蓄積期間を示す信号である。読み出しイネーブル信号 SDR2は、蓄積期間以外の期間を示す信号 SDRを元に生成された信号であり、変調、オフセット変調及びクリア時にローアクティブとなる信号である。また、ライン選択信号 VSCiは、読み出しライン及びクリアラインの選択に用いられ、クリアパルス信号 CLは、蓄積されたホール等の残留電荷を排出する期間に設定される。

[0042]

図 3 において、クリアパルス信号 C L が L レベルでライン選択信号 V S C i が H レベルになるものとする。この場合には、 P M O S トランジスタ T 1 、 N M O S トランジスタ T 2 はオンとなり、 P M O S トランジスタ T 3 はオフとなる。そうすると、ゲート電圧 V P G i は電圧 V C C S G H R となる。なお、 P M O S トランジスタ T 1 はエンハンスト型、 N M O S トランジスタ T 2 はディプレッション型の M O S トランジスタである。

[0043]

逆に、クリアパルス信号 C L が H レベルでライン選択信号 V S C が L レベルの場合には、トランジスタT1,T2 はオフとなり、トランジスタT3 はオンとなる。この場合には、ゲート電圧 V P G i はローレベルの電圧となる。なお、クリアパルス信号 C L 及びライン選択信号 V S C i が H レベルの場合には、トランジスタT1,T2,T3 はオフとなり、ゲートはフローティング状態となる。

[0044]

また、クリアパルス信号CLがLレベルの場合又はライン選択信号VSCがLレベルの場合には、NMOSトランジスタT5 はオンとなる。各ラインのトランジスタT5のソースは共通接続されてCOMノードを構成する。トランジスタT5がオンの場合には、各ラインのドレインはCOMノードに接続されてフローティング状態となる。トランジスタT5がオンの場合において、蓄積イネーブル信号SDIがLレベルのときには、PMOSトランジスタT6とNMOSトランジスタT7 もオンとなって、ドレイン電圧VPDiは電圧VCCSDIとなる。また、トランジスタT4 もオンとなって、ドレイン電圧VPDiは電圧VCCSDRとなる。また、トランジスタT4 で のうちトランジスタT5 のみがオン状態の場合には、全てのドレインはフローティング状態のCOMノードに接続されてHizとなる。

なお、トランジスタT1 には、蓄積イネーブル信号SDIがLレベルの場合に電圧VCCSGHIが供給され、信号SDRがLレベルの場合に電圧VCCSGHRが供給されるようになっている。

[0045]

即ち、図3の回路は下記表1の状態を得る。なお、表1には、着目している信号のHレベルとLレベルのみ示されている。

30

40

50

(表1)

VSC i	CL	SDI	SDR2	VPGi	
L	L			L (GND)	
L	H			L (GND)	
H	L	L		VCCSGHI	
H	L		L	VCCSGHR	
H	H			フローティング	10
VSCi	CL	SDI	SDR2	VPD i	
L		L		VCCSDI	
	L	L		VCCSDI	
L			L	VCCSDR	
	L		L	VCCSDR	
	L	H	${\mathbb H}$	H i z	

図4(a)は、図2のソース電圧供給回路VC21ないしVC2nの構成を示す回路図である。ソース電圧供給回路VC2hは、コンデンサとトランジスタを含み、各種入力信号に応じて、ソース電圧VPShを出力する。

図 4 (b) は , 図 4 (a) における S 1 、 S 2 、 S 3 及び S 4 の信号を生成するための回路を示す。

各ソース電圧供給回路VC2hは、クリアパルス信号CLの反転信号S1~S3と、プリセット信号PRの正転信号S4とが入力され、供給されているVCCSDB及びVCCVPSを用いて、図5のSOURCEバイアス電圧を発生して、各センサセルのソースに与える。

[0046]

図4(b)において、信号S1~S3はクリアパルス信号CLの反転信号であり、プリセット信号PRの正転信号S4は、クリア前ゲートプリセット信号PRがいずれもLレベルの場合には、反転信号S1~S3はHレベルであり、プリセット信号PRの正転信号S4はLレベルである。従って、NMOSトランジスタT11,T13はオンであり、PMOSトランジスタT12,T14はオフであり、NMOSトランジスタT15はオフである。即ち、この場合には、トランジスタT14,T15がオフであるので、ソース電圧供給回路VC2hはソース電圧を供給しない。なお、この時点では、ND1点の電圧値はグランドレベル(GND)であり、ND2点の電圧値はVCCSDBである。

[0 0 4 7]

また、クリアパルス信号 C L が L レベルで、クリア前ゲートプリセット信号 P R が H レベルの場合には、反転信号 S 1 ~ S 3 及びプリセット信号 P R の正転信号 S 4 は H レベルである。従って、トランジスタT 1 1 , T 1 3 , T 1 5 はオンであり、トランジスタT 1 2 , T 1 4 はオフである。即ち、この場合には、ソース電圧 V P S h は電圧 V C C V P S となり、また、N D 1 点の電圧値はグランドレベル(G N D)であり、N D 2 点の電圧値は V C C S D B まで充電される。

[0048]

また、クリアパルス信号 C L が H レベルで、クリア前 ゲートプリセット信号 P R が L レベルの場合には、反転信号 S 1 ~ S 3 及びプリセット信号 P R の正転信号 S 4 は L レベルである。従って、トランジスタT 1 1 , T 1 3 , T 1 5 はオフであり、トランジスタT 1 2

30

40

50

, T 1 4 はオンである。即ち、この場合には、N D 2 点の電圧がソース電圧 V P S h となる。仮に、この場合の直前に、コンデンサ C 1 の電圧が V C C S D B に充電されていれば、トランジスタ T 1 2 がオンすることによって N D 1 点は電圧 V C C S D B になるので、N D 2 点の電圧値は V C C S D B × 2 となる。

[0049]

即ち、図4の回路は下記表2の状態を得る。

(表2)

	CL	PR	VPSh	
1	L	L	電圧を供給しない	10
2	L	H	VCCVPS	
3	${\tt H}$	L	②の状態直後であればVCCSDB×2	

図5は、センサセルへ印加するバイアス電圧を説明するための図である。

図 5 は、各状態における、各セルのゲート電圧、ソース電圧及びドレイン電圧の電圧値を示す。なお、図 5 ではバイアス電圧の観点から、"蓄積"、"リセット(S)"、"変調(S)"、"プリセット"、"クリア"、"リセット(N)"及び"変調(N)"の各状態に分けて示している。

[0050]

図5において、GATEは、セルのゲート電圧であり、選択状態と非選択状態の2つの状態を有する。SOURCEは、セルのソース電圧である。DRAINは、セルのドレイン電圧であり、選択状態と非選択状態の2つの状態を有する。

[0051]

まず、蓄積状態の場合について説明する。

"蓄積"の状態(以下、蓄積状態という。)のとき、セルアレー中の全てのセルが選択状態とされ、電圧値がVCCSGHIである電圧が、ゲートに印加される。蓄積状態のとき、非選択のセルはない。蓄積状態のとき、ソースは、ソース電圧供給回路VC2hからのバイアス電圧の供給を受けないが、ゲートにVCCSGHIの電圧が印加され、光信号検出用MOSトランジスタPDTrがターンオンしているので、ソース・ドレイン間が導通状態になり、蓄積状態ではソースはドレイン電圧(VCCSDI)に等しくなる。

[0 0 5 2]

次に、"リセット(S)"の状態(以下、RESS状態と略す。)の場合について説明する。

選択状態のセルの場合、RESS状態のとき、電圧値がLo(Lレベル)である電圧が、ゲートに印加される。RESS状態のときは、電圧値がVMPRである電圧が、ソースに印加される。選択状態のセルの場合、RESS状態のとき、ゲートにLoの電圧が印加され、光信号検出用MOSトランジスタPDTrがオフしているので、ソース・ドレイン間が非導通状態になり、ドレインはハイインピーダンス(HiZ)となる。

[0053]

また、非選択状態のセルの場合、RESS状態のときは、電圧値がLo(Lレベル)である電圧が、ゲートに印加される。あるセルが非選択状態で、RESS状態のときは、ドレインはHiZとなる。

"変調(S)"の状態(以下、LOADS状態と略す。)において、選択状態のセルの場合、電圧値がVCCSGHRである電圧が、ゲートに印加される。選択状態のセルの場合、電圧値がVCCSDRである電圧が、ドレインに印加され、電圧値が(VCCSGHR・VthS)である電圧が、ソースに出力される。LOADS状態では、(VCCSGHR<VCCSDR)の関係が成り立つバイアス電圧を印加する必要がある。

[0 0 5 4]

また、非選択状態のセルの場合、LOADS状態のとき、電圧値がLoである電圧が、ゲ

ートに印加され、電圧値がVCCSDRである電圧が、ドレインに印加される。

続いて、"プリセット"の状態(以下、PR状態と略す。)の場合について説明する。 選択状態のセルの場合、PR状態のとき、電圧値がVCCSGHRである電圧が、ゲート に印加される。PR状態のとき、電圧値がVCCVPSである電圧が、ソースに印加され る。選択状態のセルの場合、PR状態のとき、光信号検出用MOSトランジスタPDTr がターンオンしているので、ドレインはソースと同じ電圧となる。

[0055]

また、非選択状態のセルの場合、PR状態のとき、電圧値がLoである電圧が、ゲートに印加され、ドレインはVCCVPSとなる。VSCiがLoレベルのライン(=非選択ライン)はT5がターンオンし、各ラインが共通ノード(COMノード)に接続されてCOMノードがHiZとなる。

"クリア"の状態(以下、CL状態と略す。)において、選択状態のセルの場合、電圧値が(VCCSDB×2)である電圧が、ソースに印加され、光信号検出用MOSトランジスタPDTrがターンオンしているので、ドレインはソースと同じ電圧となる。その結果、電圧値が(VCCSGHR+VCCSDB×2)の電圧が、ゲートに印加される。

[0056]

また、非選択状態のセルの場合、CL状態のとき、電圧値がLoである電圧が、ゲートに 印加され、電圧値がVCCSDRである電圧が、ドレインに印加される。

次に、"リセット(N)"の状態(以下、RESN状態と略す。)の場合について説明する。

選択状態のセルの場合、RESN状態のとき、電圧値がLoである電圧が、ゲートに印加される。RESN状態のとき、電圧値がVMPRである電圧が、ソースに印加される。選択状態のセルの場合、RESN状態のとき、ドレインはHiZとなる。

[0057]

また、非選択状態のセルの場合、RESN状態のとき、電圧値がLoである電圧が、ゲートに印加される。非選択状態のセルの場合、RESN状態のとき、ドレインはHiZとなる。

なお、クリアパルス信号 C L が L レベルの期間では、図 3 の N M O S トランジスタT 5 がターンオンしている。従って、R E S S 状態でも N M O S トランジスタT 5 はターンオンしてドレインは C O M ノードに接続される。読み出しイネーブル信号 S D R 2 は、R E S S 状態と R E S N 状態で H レベルとなるので、 P M O S トランジスタT 4 がターンオフし、 C O M ノードはフローティングとなる。

[0058]

"変調(N)"の状態(以下、LOADN状態と略す。)において、選択状態のセルの場合、電圧値がVCCSGHRである電圧が、ゲートに印加される。LOADN状態のとき、電圧値がVCCSDRである電圧が、ドレインに印加され、電圧値が(VCCSGHR-VthN)である電圧が、ソースに出力される。

[0059]

また、非選択状態のセルの場合、LOADN状態のとき、電圧値がLoである電圧が、ゲートに印加され、電圧値がVCCSDRである電圧が、ドレインに印加される。

LOADS状態と同様に、LOADN時も図3のT5がターンオンしているのでドレインはCOMノード(= H i Z) に接続される。

[0060]

図6は、センサの読み出しラインとクリアラインを説明するための図である。

図6に示すように、m×nの画素マトリックスにおいて、各ラインが第1のラインから第mのラインまで順番に走査される。読み出しラインは、光量に応じた信号が読み出されるラインであり、クリアラインは、各セルに蓄積された電荷がクリアされるラインである。第1ラインから順番に走査が行われるので、クリア用選択信号に基づいてクリアされたラインの各セルに、その後に受光した光量に応じてホールが生成される。クリア後、読み出しライン選択信号VSBiによって読み出されるまでの時間が露出時間となる。露出時間

20

10

30

40

は、読み出しラインとクリアライン間のライン数 d 1 に比例し、シャッタースピードの設定、すなわち、1 H (H は水平ライン数を示す。以下同じ。) から m H の範囲(あるいは(1 フレーム + 1 H 以上でもよい)の設定によって変更することができる。

[0061]

図 7 は、垂直同期信号 V S Y N C と水平同期信号 H S Y N C のタイミングを示すタイミングチャートである。

垂直同期信号 V S Y N C は、周期 t 1 毎に発生される、 t 2 時間長さのタイミングパルスである。水平同期信号 H S Y N C は、周期 t 3 毎に発生される、 t 4 時間長さのタイミングパルスである。垂直同期信号 V S Y N C と水平同期信号 H S Y N C は、信号処理 L S I 2 のタイミングジェネレータ 2 6 からイメージセンサ L S I 1 へ供給される。

[0062]

垂直同期信号VSYNCが供給されると、読み出しライン用シフトレジスタ5は、選択信号VSBiを順次出力する。垂直同期信号VSYNCの供給後の周期t1内において、水平同期信号HSYNCが、センサセルアレイ3のライン数(=m)だけ出力される。そして、水平同期信号HSYNCが出力されている期間t4内であってかつVGUPがLの期間に、上述した信号成分の読み出し、クリア、そしてオフセット成分の読み出しの動作が行われる期間が存在する。このVGUPがLの期間は、Hブランキング期間中の所定の期間に設定される。Hブランキング期間については、後で図9を用いて詳述する。

[0063]

周期 t 3 内の期間 t 4 後の期間 t 5 内に、 n 個の信号成分とオフセット成分のアナログ信号 V O U T S と V O U T N が出力される。

次に、イメージセンサ L S I 1 のタイミングジェネレータ(以下、 T G という) 1 3 の回路構成について図 8 を参照して説明する。

図8は、図1のイメージセンサLSI1のTG13の構成を示す回路ブロック図である。

[0064]

TGは、シリアルコントロールブロック 7 1、マスタタイミング制御ブロック 7 2、センサレジスタブロック 7 3、シャッターコントロール部 (シャッタスピード上限制御部) 7 4、フレームコントロール部 7 5、 H・ V カウンタ 7 6、 垂直スキャン制御ブロック 7 7、水平スキャン制御ブロック 7 8、 アナログ制御ブロック 7 9を含む。

[0065]

シリアルコントロールブロック 7 1 には、当該シリアルコントロールブロック 7 1 と、信号処理 L S I 2 のレジスタ 1 4 との間のインターフェース信号である 3 線シリアル I / F 信号が入出力される。

マスタタイミング制御ブロック72には、信号処理LSI2のTG26からセンサ駆動クロックSCLK,水平同期信号HSYNC及び垂直同期信号VSYNCが入力される。またTG13には、信号処理LSI2からのクロック指定信号CLK_SELと、スタンバイ信号STANDBYが入力されている。

[0066]

シリアルコントロールブロック 7 1 は、信号処理 L S I 2 のレジスタ 2 3 に書き込まれているシャッタスピードの設定データ , レギュレータ 8 の設定データ及びシステムクロック情報などをシリアル I / F 信号として入力し、これらのデータについてライトデータ , ライトアドレス及びライトストローブ信号 W R を出力し、センサレジスタブロック 7 3 に供給する。

[0067]

前記センサレジスタブロック73は、上記の入力信号に応じて、ラインシャッタスピード設定信号,フレームシャッタスピード設定信号,フレームモード設定信号,クリアパルス幅制御設定信号,クリアパルス印加回数設定信号,ゲイン設定信号及びレギュレータ電圧設定信号を出力する。

一方、マスタタイミング制御ブロック 7 2 は、前述の各種入力信号に基づいて、ピクセルクロック,水平リセットパルス,垂直リセットパルス及びリセット信号を出力する。

10

20

30

40

30

40

50

[0068]

シャッタコントロール部(シャッタスピード上限制御部) 7 4 には、センサレジスタブロック 7 3 からのラインシャッタスピード設定信号及びフレームシャッタスピード設定信号が入力され、出力としてラインシャッタスピードデータ及びフレームシャッタスピードデータを出力する。

フレームコントロール部 7 5 には、前記マスタタイミング制御ブロック 7 2 からのピクセルクロック,垂直リセットパルス及びリセット信号と、前述のスタンバイ信号 S T A N D B Y が入力され、出力としてフレームカウント値,フレーム制御データ及びバリッド(V A L I D)制御信号を出力する。

また、 H ・ V カウンタ 7 6 には、前記マスタタイミング制御ブロック 7 2 からのピクセルクロック , 水平リセットパルス , 垂直リセットパルス及びリセット信号が入力され、出力としてラインカウント値及びピクセルカウント値を出力する。

[0069]

垂直スキャン制御ブロック 7 7 には、入力として、前記シャッタコントロール部 7 4 からのラインシャッタスピードデータ及びフレームシャッタスピードデータ、前記フレームコントロール部 7 5 からのフレームカウント値,フレーム制御データ及びバリッド(VALID)制御信号、前記センサレジスタブロック 7 3 からのクリアパルス幅制御設定信号及びクリアパルス印加回数設定信号、前記マスタタイミング制御ブロック 7 2 からのピクセルクロック及びリセット信号、クロック指定信号 C L K _ S E L 、前記 H ・ V カウンタ 7 6 からのラインカウント値及びピクセルカウント値が入力される。

[0 0 7 0]

垂直スキャン制御ブロック77は、出力としてクリアライン用シフトデータAV,クリアライン用シフトクロックVCLK_ASR,クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RST,クリアライン選択イネーブル信号CLS,読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RST,読み出しライン選択イネーブル信号VSM,蓄積時全ライン選択信号VGUP,蓄積イネーブル信号SDI,読み出しイネーブル信号SDR,クリア前ゲートプリセット信号PR,クリアパルスCLを出力する。

[0071]

水平スキャン制御ブロック 7 8 には、入力として、前記フレームコントロール部 7 5 からのバリッド(VALID)制御信号、前記 H・Vカウンタ 7 6 からのラインカウント値及びピクセルカウント値、前記センサレジスタブロック 7 3 からのクリアパルス幅制御設定信号、前記マスタタイミング制御ブロック 7 2 からのピクセルクロック及びリセット信号、クロック指定信号 C L K _ S E L が入力される。

[0072]

水平スキャン制御ブロック78は、出力としてラインメモリ選択用シフトデータAH,ラインメモリ選択用シフトクロックCIN,ラインメモリ選択イネーブル信号HSC_CK,蓄積信号用ラインメモリリセット信号RESS,蓄積信号用ラインメモリデータロード信号LOADS,オフセット用ラインメモリリセット信号RESN,オフセット用ラインメモリデータロード信号LOADNを出力する。

[0 0 7 3]

上記のクロック指定信号 C L K _ S E L は、システムクロック信号 C L K I N の周波数の高低を示す信号であるが、この C L K _ S E L は垂直スキャン制御ブロック 7 7 及び水平スキャン制御ブロック 7 8 に供給されている。各制御ブロック 7 7 及びク 7 8 では、クロック指定信号 C L K _ S E L の H ,L レベルに応じて各ブロック 7 7 及びク 7 8 から出力される各種センサ駆動信号の出力タイミングを制御できるようになっている。

[0074]

アナログ制御ブロック 7 9 には、前記フレームコントロール部 7 5 からのバリッド (V A L I D) 制御信号、前記 H ・ V カウンタ 7 6 からのラインカウント値及びピクセルカウント値、前記センサレジスタブロック 7 3 からのゲイン設定信号、スタンバイ信号 S T A N

DBYが入力され、出力としてアナログアンプゲイン制御信号,アンプ用駆動クロック CDL,スタンバイ制御信号を出力する。

[0075]

そして、前記フレームコントロール部75からのバリッド(VALID)制御信号はVALID信号としてTG13から信号処理LSI2へ出力されるようになっている。また、前記センサレジスタブロック73からのレギュレータ電圧設定信号と、前記アナログ制御ブロック79からのスタンバイ制御信号とは、図1のイメージセンサLSI1のセ

ンサ駆動バイアス発生用レギュレータ8に入力される。

[0076]

前記アナログ制御ブロック79からのアナログアンプゲイン制御信号とアンプ用駆動クロックCDLとは、図1のイメージセンサLSI1の出力アンプ12の制御用信号となる。図9はセンサセルアレイ3の光電変換を制御する各信号を示すタイミングチャートである。センサセルアレイ3は、"蓄積"、"リセット(S)"、"変調(S)"、"プリセット"、"クリア"、"リセット(N)"及び"変調(N)"の各状態の繰返しによって、光学像を電気信号に変換して出力する。図9はこれらの各状態における信号の様子を示している。センサセルアレイ3は、図7の垂直同期信号VSNYC及び水平同期信号HSYNCを単位時間とした所定のフレームレートで動作する。

[0077]

図 9 の例では、あるラインカウント信号 R O W C T において、 H S Y N C が、ピクセルクロック信号 P X L C T が 1 から 8 0 まで L レベルであり、さらに P X L C T が 5 から 2 2 までが L O A D S (リセット(S) + 変調(S)) 状態に、 P X L C T が 2 7 から 4 4 までが C L (プリセット + クリア) 状態に、 P X L C T が 4 5 から 6 3 までが L O A D N (リセット(N) + 変調(N)) 状態に割り当てられている。

[0078]

なお、各制御信号はTG13によって生成され出力される。TG13は、論理回路で構成されるが、その論理回路は、Verilog・HDL、VHDL等のHDL(Hardware Description Language:ハードウエア記述言語)を利用した設計システムを用いれば、自動設計することができる。

[0079]

先ず、蓄積状態について説明する。

図7に示すHブランキング期間中の所定期間(図9の第5ピクセル~第63ピクセル)以外の期間が蓄積期間である。蓄積期間には、全画素が蓄積状態となる。この期間には、蓄積時全ライン選択信号VGUPはHレベルで、蓄積イネーブル信号SDI及びクリアパルス信号CLはLレベルである。図2に示すように、蓄積時全ライン選択信号VGUPがHレベルとなることによって全てのライン選択信号VSCiがHレベルとなり、ドレイン・ゲート電圧供給回路VC1iの動作を示す上記表1に示すように、ゲート電圧VPGiはVCCSGHIとなる。また、ドレイン電圧VPDiは電圧VCCSDIとなる。また、この期間には、クリア前ゲートプリセット信号PRもLレベルであり、ソース電圧供給回路VC2hはソース電圧供給回路VC2hはリース電圧供給回路VC2hはリース電圧供給回路VC2hはリース電圧のサースは、光信号検出用MOSトランジスタPDTrがターンオンしドレイン電圧に一致する。

[0080]

Hブランキング期間の第 5 ピクセルにおいて蓄積期間は終了し信号読み出しが開始される。この信号読み出しのための期間(LOADS,CL,LOADN期間)においても、受光光量に基づくホールの蓄積は継続されるが、各セルは蓄積期間とは異なる設定値に設定される。また、信号読み出しのための期間には、クリアライン、読み出しライン又は非選択ラインでは、各セルは個別の設定値に設定される。

[0081]

先ず、リセット(s)状態について説明する。図9に示すように、この期間においても、全てのセルに共通の設定が行われる。

20

30

30

50

図9に示すように、クリアパルス信号 CL及びクリア前ゲートプリセット信号 PRはLレベルであり、ソース電圧供給回路 VC2hはソース電圧を供給しない。この期間においては、蓄積信号用ラインメモリリセット信号 RESSがハイアクティブとなり、図2のスイッチ SW22がオンとなって、ラインメモリを構成するコンデンサC2の端子電圧はVMPRにチャージされる。更に、蓄積信号用ラインメモリデータロード信号 LOADS及びラインメモリデータロード信号 LOAD もハイアクティブとなり、スイッチ SW21及びスイッチ SW11がオンとなって、ソースラインを電圧 VMPRで初期化する。

[0082]

一方、蓄積時全ライン選択信号VGUPはHからLに変化し、全てのライン選択信号VSCiはLレベルに変化する。従って、表1に示すように、ゲート電圧VPSGiは全てL(GND)レベルとなる。また、蓄積イネーブル信号SDIはHレベルであり、SDR2もHレベルであるため、表1に示すように、図3中のT5がターンオンしているので、全てのセルのドレインは共通に接続され(COMノード)、そのCOMノードはHiz状態となる。

[0083]

次に、変調(s)状態について説明する。

図9に示すように、CL,PRはLレベルを維持しており、ソース電圧供給回路VC2hはソースラインに電圧を供給していない。各セルに設定した電圧値に応じた出力がソースラインを介して出力される。即ち、クリアライン及び非選択ラインについてはライン選択信号VSCiはLレベルのままであり、ゲート電圧はL(GND)レベルである。また、読み出しイネーブル信号SDR2もLレベルであるので、ドレイン電圧VPDiはVCCSDRとなる。

[0084]

読み出しラインについてはライン選択信号 V S C i は H レベルである。クリアパルス信号 C L 及び信号 S D R が L レベルであるので、ゲート電圧 V P G i は V C C S G H R である。ドレイン電圧 V P D i は V C C S D R である。これにより、ソース電圧 V P S i には電圧 (V C C S G H R - V t h S) が現れる。なお、 V t h S は、蓄積されたホールに応じて変化する。ソースラインの電圧(V C C S G H R - V t h S) は、スイッチ S W 2 1 を介してラインメモリを構成する各コンデンサ C 2 に蓄積される。

[0085]

次に、相関2重サンプリング処理のために、読み出しラインの各セルに蓄積されているホールを除去(クリア)するためのCL状態を設定する。ホールの除去のためには極めて高い電圧をゲートに印加する必要があり、クリア状態の前にプリセット状態を設定して、倍圧回路を利用して高電圧を得るようになっている。なお、読み出しラインのクリアと同時にクリアラインの各セルのクリアも行うようになっている。

[0086]

先ず、プリセット状態においては、読み出しラインとクリアラインについては、ライン選択信号 V S C i は H レベルである。クリアパルス信号 C L 及び信号 S D R は L レベルであるので、ゲート電圧 V P G i は V C C S G H R である。なお、非選択ラインについては、ライン選択信号 V S C i が L レベルであるので、ゲート電圧は L (G N D) レベルである

[0087]

また、クリアパルス信号CLはLレベルで、クリア前ゲートプリセット信号PRはHであるので、表2に示すように、全ソースラインの電圧VPShは電圧VCCVPS(例えば 0 V)にリセットされる。また、図4のコンデンサC1 は電圧VCCSDBがチャージされ、ND2点は電圧VCCSDBとなる。なお、蓄積イネーブル信号SDI及び読み出しイネーブル信号SDR2はHレベルであるので、ドレインは、光信号検出用MOSトランジスタPDTrがターンオンして、ソースと同電位になる。

[0088]

次に、クリア状態においては、クリア前ゲートプリセット信号PRがHレベルからLレベ

ルに変化し、クリアパルス信号CLがLレベルからHレベルに変化する。この場合には、表2に示すように、ソースラインは電圧VCCSDB×2に変化する。また、読み出しラインとクリアラインについては、クリアパルス信号CL及びライン選択信号VSCiがHレベルであるので、表1に示すように、ゲートはフローティング状態となる。従って、ソースとゲートとのカップリング容量によって、ゲート電圧VPGiは(VCCSDB×2+VCCSGHR)となる。また、ドレインはプリセット状態時と同様に、光信号検出用MOSトランジスタPDTrがターンオンして、ソースと同電位になる。

[0089]

一方、非選択ラインについては、ゲート電圧 V P G i は L (G N D)レベルのままであり、ドレイン電圧 V P D i は、トランジスタ T 4 がオンとなるので、 V C C S D R となる

次に、リセット(N)状態を経て、変調(N)状態に移行する。これらのリセット(N)状態及び変調(N)状態は、夫々リセット(s)状態及び変調(s)状態と略同様の信号が設定される。即ち、リセット(N)状態においては、蓄積信号用ラインメモリリセット信号RESS,蓄積信号用ラインメモリデータロード信号LOADSに夫々代えてオフセット用ラインメモリリセット信号RESN,オフセット用ラインメモリデータロード信号LOADNがハイアクティブとなる。これにより、スイッチSW32がオンとなって、ノイズ読み出し用のラインメモリを構成するコンデンサC3 がVMPRにチャージされる。更に、スイッチSW31及びスイッチSW11がオンとなって、ソースラインは電圧VMPRで初期化される。

[0090]

変調(N)状態においては、クリアパルス信号 C L , クリア前ゲートプリセット信号 P R は L レベルであり、ソース電圧供給回路 V C 2 h はソースラインに電圧を供給しない。クリアライン及び非選択ラインについてはライン選択信号 V S C i は L レベルであり、ゲート電圧 V P G i は L (GND)である。また、読み出しイネーブル信号 S D R 2 も L レベルであるので、ドレイン電圧 V P D i は V C C S D R となる。

[0091]

読み出しラインについてはライン選択信号VSCiはHレベルである。クリアパルス信号CL及び信号SDRがLレベルであるので、ゲート電圧VPGiはVCCSGHRである。ドレイン電圧VPDiはVCCSDRである。これにより、ソース電圧VPShには電圧(VCCSGHR・VthN)が現れる。このソースに現れる電圧は、直前にクリア状態に設定されていることから、オフセット成分に対応したものとなっている。ソースラインの電圧(VCCSGHR・VthN)は、スイッチSW31を介してラインメモリを構成する各コンデンサC3 に蓄積される。

[0092]

こうして、コンデンサ C 2 には信号成分が蓄積され、コンデンサ C 3 にはオフセット成分が蓄積される。水平シフトレジスタ 1 1 からの選択信号 H S C A N h によって、スイッチ S W 2 3 , S W 3 3 が順番にオンになることで、コンデンサ C 2 , C 3 に蓄積された電圧が夫々出力アンプ 3 6 , 3 8 を介して V O U T S , V O U T N として出力される

[0 0 9 3]

次に、固体撮像素子による撮像の条件が変更された場合、読み出しライン用シフトレジスタとクリアライン用シフトレジスタの制御について説明する。

始めに、 蓄 積 期 間 等 に お け る 読 み 出 し ラ イ ン 用 シ フ ト レ ジ ス タ と ク リ ア ラ イ ン 用 シ フ ト レ ジ ス タ の 制 御 の 必 要 性 に つ い て 説 明 す る 。

まず、蓄積期間等におけるダミーの読み出し制御の必要性について説明する。

イメージセンサLSI1が撮像動作中に、撮像条件が変更、例えば、シャッタースピードが変更されると、その変更前のシャッタースピードにより決められるクリアライン用シフトデータAVがクリアライン用シフトレジスタ4内をシフトしている状態で、さらに、変更後のシャッタースピードにより決められるタイミングでさらにもう一つのクリアライン

20

10

30

40

30

40

50

用シフトデータAVがクリアライン用シフトレジスタ4に入力される。その結果、それに続く蓄積期間すなわち露出サイクル中にクリアラインの選択信号が2つ存在することになるため、一つの画像中に画質が異なる部分が生じてしまうことになる。

[0094]

これは、Hブランキング期間において、例えば、クリアラインが1本選択されている場合と2本選択されている場合では、ソース線の有する容量が変化してしまう。従って、これら2つの場合において、クリア後におけるセンサセルアレイ3中のキャリアの状態、例えば残留電荷量が異なってしまう。その結果、次のVALIDサイクルにおいて読み出した画像中に画質が異なる部分が生じてしまうからである。ここで、露出サイクルに続くサイクルを非VALIDサイクル、すなわちVALID信号がLレベルであるサイクルとして、非VALIDサイクルの画像を出力画像として利用しないことも考えられる。

[0095]

しかし、非VALIDサイクルの画像は、出力画像として利用されないため、無駄な画像となってしまう。特に、自動露出制御によってシャッタースピードが変更される場合、フレームレイトが低下する。

そこで、ここでは、シャッタースピード等の撮像条件が変更された場合、無駄な画像が生成されるのを防ぐために、撮像条件変更後の露出サイクルの開始時あるいは開始前等の所定のタイミングにおいてクリアライン用シフトレジスタ4にクリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTが入力され、かつその露出サイクルにおいてダミーの読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力される。その結果、露出サイクル(蓄積期間)とそれに続くVALIDサイクルにおいて、それぞれの読み出しラインの数とクリアラインの数が同じになるので、露出サイクルに続くサイクルをVALIDサイクルとすることができる。

[0096]

ここで、クリアライン用シフトレジスタリセット信号 V S F R A __ R S T が、クリアライン用シフトレジスタ 4 に入力される所定のタイミングとしては、例えば H ブランキング期間経過後である。

さらに、固体撮像素子の動作中に、その他の種々の撮像条件が変更された場合にも、上述した理由と同様の理由から、露出サイクルに続くサイクルを非VALIDサイクルとして、非VALIDサイクルの画像を出力画像として利用しないことも考えられるが、非VALIDサイクルの画像は、出力画像として利用されないため、無駄な画像となってしまう

[0097]

従って、このような無駄な画像を生じさせないようにするために、読み出しライン用シフトレジスタ 5 とクリアライン用シフトレジスタ 4 の適切な制御が行われる。

また、イメージセンサLSI1が撮像動作中に、撮像条件の一つである、センサセルアレイ3のスキャン方向を変更、例えば、2次元のマトリックスの上から下へスキャンしていたのを下から上へスキャンするような変更があった場合、その変更前のスキャン方向により決められる読み出し信号が読み出しライン用シフトレジスタ5内をシフトしている読み出し信号が読み出しライン用シフトレジスタ5に入力される。その結果、それに続く露出サイクル中に読み出しラインの選択信号が2つ存在してしまう場合もあり、上述した理由と同様の理由から、一つの画像中に画質が異なる部分が生じてしまうことになる。よって、露出サイクルに続くサイクルを非VALIDサイクル、すなわちVALID信号がLであるサイクルとして、非VALIDサイクルの画像を出力画像として利用しないことも考えられる。

[0098]

しかし、非VALIDサイクルの画像は、出力画像として利用されないため、無駄な画像となってしまう。

そこで、ここでは、スキャン方向が変更された場合、無駄な画像が生成されるのを防ぐた

めに、スキャン方向変更後の露出サイクルの開始時あるいは開始前等の所定のタイミングにおいて読み出しライン用シフトレジスタ 5 に読み出しライン用シフトレジスタリセット信号 V S F R B R S T が入力され、露出サイクル中に読み出しラインの選択信号が 2 つ存在してしまうことを防ぎ、かつその露出サイクルにおいてダミーの読み出しライン用シフトデータ B V が読み出しライン用シフトレジスタ 5 に入力される。その結果、その露出サイクル(蓄積期間)とそれに続く V A L I D サイクルとにおいて、それぞれの読み出しラインの数とクリアラインの数が同じになるので、露出サイクルに続くサイクルを V A L I D サイクルとすることができる。

[0099]

ここでも、 VSFRB __ RSTが、 読み出しライン用シフトレジスタ 5 に入力される所定のタイミングとしては、例えば H ブランキング期間経過後である。

従って、このような無駄な画像を生じさせないようにするために、読み出しライン用シフトレジスタ5の適切な制御が行われる。

[0100]

はじめに、ダミーの読み出しが行われる条件について説明する。

以下の条件でダミーの読み出し制御が実行される。

a)アイドル終了後の蓄積期間(露出時間)

b) シャッタースピードが 1 H (H は水平ラインを示す。以下同じ。) から m H の範囲の 設定されている場合に、フレームレイト変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル

c) シャッタースピードが 1 H から m H の範囲の設定されている場合に、シャッタースピード変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル

d) シャッタースピードが 1 H から m H の範囲の設定されている場合に、上下、あるいは 左右スキャン方向の変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル

e) シャッタースピードが 1 H から m H の範囲の設定されている場合に、フレームレイトが 7 . 5 フレーム毎秒以下における間引きフレーム

各条件について図 1 0 から図 1 9 を用いて説明する。図 1 0 から図 1 3 は、ダミー読み出しを説明するためのタイミングチャートである。図 1 0 から図 1 3 は、横軸は時間を示し、各信号が時間と共に変化する様子を示す。以下、センサセルアレイ 3 が 5 0 0 H、すなわちセンサセルアレイ 3 のライン数が O B 領域を含めて 5 0 0 である場合の例で説明する

[0101]

なお、以下の例では、蓄積期間(Exposure Time)とは、アイドル終了後の蓄積フレーム、可変フレームもしくは15fpsにおけるフレームレイト変更後の蓄積フレーム、可変フレームもしくは15fpsにおけるシャッタースピード変更後の蓄積フレーム、及び可変フレームもしくは15fpsにおける上下、左右スキャン方向変更後の蓄積フレームをいう。

蓄積サイクル(Exposure Cycle)とは、7.5fps以下におけるフレームレイト変更後の蓄積フレーム、7.5fps以下におけるシャッタースピード変更後の蓄積フレーム、及び7.5fps以下における上下、左右スキャン方向変更後の蓄積フレームをいう。

[0102]

VALID サイクル(Valid Cycle)とは、画像データ出力フレーム、すなわち VALID 信号が H レベルのときをいう。

間引きフレームとは、7.5fps以下における蓄積期間(ExposureTime)と蓄積サイクル(Exposure Сycle)を除いた画像データを出力しないフレーム、すなわちVALID信号がLレベルのときをいう。

[0103]

a)アイドル終了後の蓄積期間(露出時間)

図 1 0 は、アイドル期間終了後の蓄積期間において、ダミーの読み出しが行われることを 示すタイミングチャートである。 30

20

50

20

30

40

50

[0104]

図10において、スタンバイ信号であるSTANDBYがLレベルからHレベルに変わった後、垂直同期信号VSYNCが入力され、最初のアイドル期間(Idle1)になり、クリアライン用シフトデータAVがクリアライン用シフトレジスタ4に入力される。続いて、垂直同期信号VSYNCが入力されて、2回目のアイドル期間(Idle2)になり、クリアライン用シフトデータAVがクリアライン用シフトレジスタ4に入力される。これらのアイドル期間において、クリアライン用シフトデータAVが入力されると、スキャン方向指定信号VSCANで指定された方向に(図では1からm(500)の方向に)、ラインが選択されていくようにクリアライン選択信号VSAが、クリアライン用シフトレジスタ4から順次出力される。

[0105]

その2回目のアイドル期間(Idle2)において、チップイネーブル信号であるSENSENがLレベルからHレベルになると、イメージセンサLSI1がアクティブ状態となる。そのアクティブ状態になった後、垂直同期信号VSYNCの最初の立下りのタイミングで、モード(可変フレーム、固定フレーム等)とシャッタースピードのデータすなわち設定条件の情報が読み取られる。そして、アイドル期間(Idle2)の最後において、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTと読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTが、それぞれクリアライン用シフトレジスタ4と読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、両レジスタをリセットしつでは、アイドル期間(Idle2)において、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTのパルス信号の立ち上がりに応じて、クリアライン選択信号VSA[500]のパルス信号は立ち下がり、クリアライン用シフトレジスタ4はリセットされる。

[0106]

なお、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTと読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTが入力されてクリアライン用シフトレジスタ4と読み出しライン用シフトレジスタ5は、それぞれクリアライン用シフトデータAVと読み出しライン用シフトデータBVが入力されないかぎり、それぞれクリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBを出力しない。

[0107]

入力あるいは設定条件の情報情報に基づいて、2回目のアイドル期間に続く蓄積期間(Exposure Time)において蓄積動作が実行される。

本来は、蓄積期間であれば読み出しライン用シフトデータBVを入力する必要はないが、蓄積期間においてダミー読み出しをするために、蓄積期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、読み出しライン用シフトクロックVCLK_BSRに基づいて読み出しライン選択信号VSBが順次出力される。図10において、蓄積期間(Exposure Time)のDRで示す範囲において、ダミー読み出しが、画像信号が出力画像として利用されないにも拘わらず、行われる。そのダミー読み出しが終了すると、次の期間開始時にVALID信号が出力される。

[0108]

図10において、Modeは、フレームレイトモードを示し、この場合、フレームレイトモードは、可変フレームのモードである。同様に、Shutter Speedは、シャッタースピードを示し、この場合、シャッタースピードは250Hである。ここで、可変フレームモードは、シャッタースピードに応じて、フレームレイトを変更するモードである。固定フレームモードは、シャッタースピードが変わっても、フレームレイトが変わらないモードである。シャッタースピードは、クリアライン用シフトデータAVと読み出しライン用シフトデータBVの時間の差によって決まる。

[0109]

スキャン方向指定信号VSCANは、水平方向におけるスキャン方向を指示する信号であ

20

30

40

50

る。図10では、スキャン方向指定信号 V S C A N は、 L レベルであるので、スキャン方向は、1から500へ向かう方向である。なお、スキャン方向指定信号 V S C A N が H レベルのときは、スキャン方向は、500から1へ向かう方向となる。

VCLK_ASRは、クリアライン用シフトレジスタ4のシフトクロック信号である。VCLK_BSRは、読み出しライン用シフトレジスタ5のシフトクロック信号である。クリアライン用シフトレジスタ4への入力パルス信号であるクリアライン用シフトデータAVが入力されると、クリアライン用シフトレジスタ4の第1のラインからクリアライン選択信号VSAが順次出力されていく。同様に、読み出しライン用シフトレジスタ5の入力パルス信号である読み出しライン用シフトデータBVが入力されると、読み出しライン用シフトレジスタ5から読み出しライン選択信号VSBが順次出力されていく。

[0110]

例えば、3線シリアルインターフェース15を介して指定されたシャッタースピードのデータに基づいて決まる、読み出しラインとクリアライン間のライン数が200、すなわち200Hであるとすると、クリアライン用シフトデータAVは、蓄積期間(Exposure Time)において、読み出しラインカウンタ(図示せず)の値が300になったときに、クリアライン用シフトレジスタ4は、1行目の選択信号VSA[1]を出力する。クリアライン選択信号VSA[1]が出力されるとき、読み出しライン選択信号VSB[301]がほぼ同時に出力される。

[0111]

その後、読み出しライン選択信号 V S B の出力に対応して、クリアライン用シフトレジスタ 4 は、クリアライン用シフトクロック信号 V C L K _ A S R のクロック信号に基づいて、順次クリアライン選択信号 V S A を、クリアラインと読み出しライン間のライン数を 2 5 0 の状態に維持しながら、出力する。

[0112]

その結果、各日ブランキングのクリア期間において、クリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBによるクリアされるラインの選択数(以下、選択ライン数という。)が同じとなる。

[0113]

その後、クリアライン選択信号 V S A と読み出しライン選択信号 V S B が順次出力されていき、読み出しライン選択信号 V S B が 5 0 0 ライン目を選択すると、次のサイクルのための読み出しライン用シフトデータ B V が、読み出しライン用シフトレジスタ 5 に入力され、読み出しライン選択信号 V S B はまた、先頭の 1 ライン目から選択をしていくように出力される。

蓄積期間の次のサイクルは、VALIDサイクル(Valid Cycle)となる。それ以降、すなわち読み出しライン選択信号VSBによる先頭ラインからの読み出し以降は、すべてクリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBによる選択ライン数が同じになるので、1フレーム内での画質の差が生じない。

よって、蓄積期間においてダミー読み出しが行われることによって、次の期間は、VALIDサイクル期間となるので、露出サイクルに続くサイクルにおいて出力画像として利用されない無駄な画像が生じない。

[0 1 1 4]

b) シャッタースピードが 1 H から m H の 範囲の設定されている場合に、フレームレイト 変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル

図11は、シャッタースピードが1Hから500Hの範囲の設定されている場合に、フレームレイト変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクルにおいて、ダミー読み出しが行われることを示すタイミングチャートである。

[0115]

イメージセンサLSI1が撮像動作中に、モードが可変フレームモードから15fpsの固定フレームモードに変更されると、図11においてVALIDサイクルにおける垂直同期信号VSYNCの立下リタイミングでそのモード変更情報が読み取られ、次の蓄積期間

(23)

(Exposure Time)においてダミー読み出しが行われる。

[0116]

図11において、垂直同期信号VSYNCの最初の立下りで、モード(可変フレーム、固定フレーム等)とシャッタースピードの入力あるいは設定条件を読み取って、その情報に基づいて、次の蓄積期間において蓄積動作が実行される。

また、垂直同期信号 V S Y N C の立下がりに応じて、クリアライン用シフトレジスタリセット信号 V S F R A R S T が出力されて、クリアライン選択信号 V S A が出力されないようにクリアライン用シフトレジスタ 4 がリセットされる。図 1 1 では、クリアライン用シフトレジスタリセット信号 V S F R A R S T のパルス信号の立ち上がりに応じて、クリアライン選択信号 V S A [2 5 0] のパルス信号(図示せず)は立ち下がり、クリアライン用シフトレジスタ 4 はリセットされる。

[0 1 1 7]

本来は、蓄積期間であれば読み出しライン用シフトデータBVを入力する必要はないが、蓄積期間においてダミー読み出しをするために、蓄積期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、読み出しライン用シフトクロック信号VCLK_BSRに基づいて読み出しライン選択信号VSBが順次出力される。図11において、蓄積期間(Exposure Time)のDRで示す範囲において、ダミー読み出しが、画像信号が出力画像として利用されないにも拘わらず、行われる。そのダミー読み出しが終了すると、次の期間開始時にVALID信号が出力される。

[0118]

読み取られた変更情報に基づいて、VALIDサイクルに続く蓄積期間(Exposure Time)における動作は実行されるので、設定されたシャッタースピードに基づいてクリアライン用シフトデータAVが出力される。例えば、図ではシャッタースピードは250Hであるので、クリアライン用シフトデータAVは、読み出しラインカウンタの出力が251になったときから、出力され、クリアライン選択信号VSA[1]が出力される。クリアライン選択信号VSA[1]が出力されるとき、読み出しライン選択信号VSB[251]がほぼ同時に出力される。

その後、読み出しライン選択信号 V S B の出力に対応して、クリアライン用シフトレジスタ 4 は、クリアライン用シフトクロック信号 V C L K _ A S R のクロック信号に基づいて、順次クリアライン選択信号 V S A を、クリアラインと読み出しライン間のライン数を 2 5 0 の状態に維持しながら、出力する。

[0119]

その結果、各Hブランキングのクリア期間において、クリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBによるクリアされるラインの選択数が同じとなる。

その後、蓄積期間(Exposure Time)において、クリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBが順次出力されていき、読み出しライン選択信号VSBが500ライン目を選択すると、読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、読み出しライン選択信号VSBはまた、先頭の1ライン目から選択をしていくように出力される。

[0120]

蓄積期間の次のサイクルは、VALIDサイクル(Valid Cycle)となる。それ以降、すなわち読み出しライン選択信号VSBによる先頭ラインからの読み出し以降は、すべてクリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBによる選択ライン数が同じになるので、1フレーム内での画質の差が生じない。

[0121]

よって、蓄積期間においてダミー読み出しが行われることによって、次の期間は、VALIDサイクル期間となるので、フレームレイト変更後の蓄積サイクルに続くサイクルにおいて、出力画像として利用されない無駄な画像は生じない。

[0 1 2 2]

c) シャッタースピードが1HからmHの範囲の設定されている場合に、シャッタースピ

20

10

30

40

20

30

40

50

ード変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル

図12は、シャッタースピードが1HからmHの範囲の設定されている場合に、シャッタースピード変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクルにおいて、ダミー読み出しが行われることを示すタイミングチャートである。

[0123]

イメージセンサLSI1が撮像動作中に、図12に示すように、シャッタースピードが、例えば、500Hから250Hに変更されると、垂直同期信号VSYNCの立下リタイミングでそのシャタースピード変更の情報が読み取られ、その読み取られた変更情報に基いて、次の蓄積期間(Exposure Time)においてダミー読み出しが行われる。

[0 1 2 4]

図12において、垂直同期信号VSYNCの最初の立下りで、モード(可変フレーム、固定フレーム等)とシャッタースピードの入力あるいは設定条件を読み取って、その情報に基づいて、次の蓄積期間において蓄積動作が実行される。 図12に示すように、シャッタースピードが500Hから250Hに変更されると、その変更後の垂直同期信号VSYNCの立下りのタイミングにおいて変更後のシャッタースピードへの変更情報が読み取られる。その垂直同期信号VSYNCの立下がりに応じて、VSFRA_RSTが出力され、クリアライン選択信号VSAが出力されないようにクリアライン用シフトレジスタ4がリセットされる。図12では、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSA[500]のパルス信号は立ち下がり、クリアライン用シフトレジスタ4はリセットされる。

[0 1 2 5]

本来は、蓄積期間であれば読み出しライン用シフトデータBVを入力する必要はないが、蓄積期間においてダミー読み出しをするために、蓄積期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、読み出しライン用シフトクロック信号VCLK_BSRに基づいて読み出しライン選択信号VSBが順次出力される。図12において、蓄積期間(Exposure Cycle)のDRで示す範囲において、ダミー読み出しが、画像信号が出力画像として利用されないにも拘わらず、行われる。そのダミー読み出しが終了すると、次の期間開始時にVALID信号が出力される

[0126]

読み取られた変更情報に基づいて、VALIDサイクルに続く蓄積期間(Exposure Cycle)の動作は実行され、変更されたシャッタースピードにクリアライン用シフトデータAVが出力される。例えば、図12ではシャッタースピードは250Hであるので、クリアライン用シフトデータAVは、読み出し行カウンタの出力が251になったときに、出力される。

[0127]

その結果、各 H ブランキングのクリア期間において、クリアライン選択信号 V S A と読み出しライン選択信号 V S B によるクリアラインの選択数が同じとなる。

その後、蓄積期間(Exposure Сycle)において、クリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBが順次出力されていき、読み出しライン選択信号VSBが500ライン目を選択すると、読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、読み出しライン選択信号VSBはまた、先頭の1ライン目から選択をしていくように出力される。

[0128]

蓄積期間の次のサイクルは、VALIDサイクル(Valid Cycle)となる。それ以降、すなわち読み出しライン選択信号VSBによる先頭ラインからの読み出し以降は、すべてクリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBによる選択ライン数が同じになるので、1フレーム内での画質の差が生じない。

[0 1 2 9]

そして、図12の例では、モードが、7.5フレーム毎秒の固定モードであるので、VA

LIDサイクルに続くフレームは、間引きフレームとなる。よって、 2 フレームに 1 回の 読み出し、すなわち 2 フレームに 1 回の間引きが行われる。間引きフレームのときにもダ ミー読み出しが行われる。この間引きフレーム中は、 V A L I D 信号は出力されない。

[0130]

本来は、間引きフレーム期間であれば読み出しライン用シフトデータBVを入力する必要はないが、間引きフレーム期間においてダミー読み出しをするために、間引きフレーム期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが出力され、読み出しライン用シフトクロック信号VCLK_BSRに基づいて読み出しライン選択信号VSBが順次出力される。そのダミー読み出しが終了すると、次の期間開始時にVALID信号が出力される。

[0 1 3 1]

このように、間引きフレームとVALIDサイクルが交互に繰り返されるが、その間引きフレーム中にもダミー読み出しが行われ、選択ライン数が同じになるので、 1 フレーム内での画質の差が生じない。

よって、蓄積期間においてダミー読み出しが行われることによって、次の期間は、VALIDサイクル期間となるので、フレームレイト変更後の蓄積サイクルに続くサイクルにおいて、出力画像として利用されない無駄な画像は生じない。

[0132]

d) シャッタースピードが 1 H から m H の範囲の設定されている場合に、上下、あるいは 左右スキャン方向の変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル

図13は、シャッタースピードが1Hから500Hの範囲の設定されている場合に、上下、あるいは左右スキャン方向の変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクルにおいて、ダミー読み出しが行われることを示すタイミングチャートである。

[0133]

イメージセンサLSI1が撮像動作中に、図13に示すように、スキャン方向が変更されると、垂直同期信号VSYNCの立下リタイミングでその情報が読み取られ、次の蓄積期間(Exposure Cycle)においてダミー読み出しが行われる。

なお、スキャン方向は、垂直方向における変更の例で説明するが、水平方向における変更、すなわち左右方向の変更の場合でも、以下に説明するダミー読み出しは同様に適用される。

[0134]

図13に示すように、5フレーム毎秒の固定フレームモードで、シャッタースピードは250日であるので、スキャン方向を示す信号であるスキャン方向指定信号VSCANがLレベルからHレベルに変更されると、その変更後の垂直同期信号VSYNCの立下りのタイミングにおいてそのスキャン方向の変更情報が読み取られる。VALIDサイクルにおいて、その垂直同期信号VSYNCの立下がりに応じて、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTと読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTが出力され、クリアライン選択信号VSAと読み出しライン選択信号VSBが出力されないようにクリアライン用シフトレジスタ4と読み出しライン用シフトレジスタ5がリセットされる。

[0135]

図13では、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTのパルス信号の立ち上がりに応じて、クリアライン選択信号VSA[250]のパルス信号(図示せず)は立ち下がり、クリアライン用シフトレジスタ4はリセットされ、読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTのパルス信号の立ち上がりに応じて、読み出しライン選択信号VSB[500]のパルス信号は立ち下がり、読み出しライン用シフトレジスタ5はリセットされる。

本来は、蓄積期間であれば読み出しライン用シフトデータBVを入力する必要はないが、 蓄積期間においてダミー読み出しをするために、蓄積期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、読み出しライン用シフトクロック信号VCLK_BSRに基づいて読み出しライン選択信号VSBが順次出力さ 10

20

30

40

れる。

[0136]

[0 1 3 7]

その結果、各 H ブランキングのクリア期間において、クリアライン選択信号 V S A と読み出しライン選択信号 V S B によるクリアラインの選択数が同じとなる。

その後、クリアライン選択信号 V S A と読み出しライン選択信号 V S B が順次出力されていく。読み出しライン選択信号 V S B が最後の 1 行目を選択すると、読み出しライン用シフトデータ B V が読み出しライン用シフトレジスタ 5 に入力され、読み出しライン選択信号 V S B はまた、先頭の 5 0 0 行目から選択をしていくように出力される。

そして、図13の例では、モードが、5フレーム毎秒の固定モードであるので、蓄積期間 (Exposure Сycle)に続くフレームは、間引きフレームとなる。

[0138]

本来は、間引きフレーム期間であれば読み出しライン用シフトデータBVを入力する必要はないが、間引きフレーム期間においてダミー読み出しをするために、間引きフレーム期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが出力され、読み出しライン用シフトクロック信号VCLK_BSRに基づいて読み出しライン選択信号VSBが順次出力される。間引きフレーム中は、VALID信号は出力されない。間引きフレーム期間のダミー読み出しが終了すると、次の期間の開始時にVALID信号が出力される。

[0139]

そのVALID信号が出力されているVALIDサイクル後は、2回の間引きフレームと1回のVALIDサイクルの繰り返しとなる。間引きフレームでは、3フレームに1回の読み出し、すなわち3フレームに1回の間引きが行われる。その結果、2回の間引きフレーム中にもダミー読み出しが行われ、選択ライン数が同じになるので、1フレーム内での画質の差が生じない。

よって、スキャン方向の変更後の蓄積期間においてダミー読み出しが行われることによって、次の期間は、VALIDサイクル期間となるので、スキャン方向の変更後の蓄積サイクルに続くサイクルにおいて、出力画像として利用されない無駄な画像は生じない。

[0140]

e)シャッタースピードが 1 H から m H の範囲の設定されている場合に、フレームレイトが 7 . 5 フレーム毎秒以下における間引きフレーム

図 1 2 及び図 1 3 を用いて、シャッタースピードが 1 H から 5 0 0 H の範囲の設定されている場合に、フレームレイトが 7 .5 フレーム毎秒以下における間引きフレームにおいて、ダミー読み出しが行われることを説明する。

[0141]

イメージセンサLSI1が撮像動作中に、図12に示すように、シャッタースピードが、500Hから250Hに変更されると、垂直同期信号VSYNCの立下リタイミングでその情報が読み取られ、次の蓄積時間においてダミー読み出しが行われる。さらに、図12では、上述したように、モードが7.5フレーム毎秒の固定モードであるので、2フレームに1回の読み出し、すなわち2フレームに1回の間引きが行われる。よって、間引きフレームのときにもダミー読み出しが行われる。

[0142]

また、図13において、スキャン方向が変更されると、垂直同期信号VSYNCの立下リタイミングでその情報が読み取られ、次の蓄積時間においてダミー読み出しが行われる。

10

20

30

40

30

40

50

さらに、図13では、上述したように、モードが5フレーム毎秒のモードであるので、3フレームに1回の読み出しとなる。最初の蓄積期間後は、1回の間引きフレームとVALIDフレームがあり、その後は、3フレームに2回の間引きが行われる。その間引きフレームのときにもダミー読み出しが行われる。

[0143]

本来は、間引きフレーム期間であれば読み出しライン用シフトデータBVを入力する必要はないが、間引きフレーム期間においてダミー読み出しをするために、間引きフレーム期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5に入力され、読み出しライン用シフトクロック信号VCLK_BSRに基づいて読み出しライン選択信号VSBが順次出力される。図12及び図13において、間引きフレームのDRで示す範囲において、ダミー読み出しが、画像信号が出力画像として利用されないにも拘わらず、行われる。そのダミー読み出しが終了すると、次の期間開始時にVALID信号が出力される。

[0144]

上述したように、間引きフレーム中にもダミー読み出しが行われ、選択ライン数が同じになるので、 1 フレーム内での画質の差が生じない。

よって、間引きフレーム中にもダミー読み出しが行われることによって、次の期間は、VALIDサイクル期間となるので、間引きフレームに続くサイクルにおいて、出力画像として利用されない無駄な画像は生じない。

[0145]

次に、ダミー読み出しが禁止される場合について説明する。

上述したように、所定の条件の場合、蓄積期間、蓄積サイクルあるいは間引きフレームにおいて、各サイクルの各 H プランキングにおける選択ライン数が同じになるようにダミー読み出しが行われる。しかし、シャッタースピードが 1 フレーム(以下、フレームを F と略すこともある。)を超える場合、すなわち(1 フレーム + 1 H)以上に設定されている場合であって、次のような条件に合致する場合には、そのダミー読み出しを禁止する制御が行われる。

[0146]

f) シャッタースピードが 1 フレームを超える場合、すなわち(1 フレーム + 1 H) 以上に設定されている場合に、フレームレイト変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル(図 1 4)

g) シャッタースピードが 1 フレームを超える場合、すなわち(1 フレーム + 1 H) 以上に設定されている場合に、シャッタースピード変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル(図 1 5)

h)シャッタースピードが1フレームを超える場合、すなわち(1フレーム + 1 H)以上に設定されている場合に、上下、あるいは左右スキャン方向の変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクル(図16)

なお、図14から図16では、シャッタースピードは(250H+1F)である。

[0 1 4 7]

図14は、シャッタースピードが1フレームを超える場合、すなわち(1フレーム+1H)以上に設定されている場合に、フレームレイト変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクルにおいて、ダミー読み出しが禁止される場合を説明するためのタイミングチャートである

図 1 5 は、シャッタースピードが 1 フレームを超える場合、すなわち(1 フレーム + 1 H) 以上に設定されている場合に、シャッタースピード変更後の蓄積期間もしくは蓄積サイクルにおいて、ダミー読み出しが禁止される場合を説明するためのタイミングチャートである。

図16は、シャッタースピードが1フレームを超える場合、すなわち(1フレーム+1H)以上に設定されている場合に、上下、あるいは左右スキャン方向の変更後の蓄積期間も しくは蓄積サイクルにおいて、ダミー読み出しが禁止される場合を説明するためのタイミ ングチャートである。

[0148]

図14から図16に示すように、シャッタースピードが1フレームを超える場合、VALIDサイクルにおいて、フレームレイトの変更、シャッタースピードの変更、スキャン方向の変更がされると、VALIDサイクルに続く蓄積期間においてダミー読み出しが禁止される。ダミー読み出しが禁止されるとは、具体的には、読み出しライン用シフトレジスタ5への読み出しライン用シフトデータBVが読み出しライン用シフトレジスタ5へ入力されないことをいう。

[0149]

すなわち、あるVALIDサイクルにおいてフレームレイト等が変更されると、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTが所定のタイミングでクリアライン用シフトレジスタ4に入力される。そして、蓄積期間が2サイクル必要なため、蓄積期間においてクリアライン用シフトデータAVが出力されてクリアライン選択信号VSAが出力されている2サイクルの間は、読み出しライン用シフトデータBVは出力されず、その2つの蓄積期間が終了後のVALID期間の経過後は、2回の蓄積期間が続く。その2回の蓄積期間では、クリアライン用シフトデータAVが出力されてクリアライン選択信号VSAが出力されている2サイクルの間は、読み出しライン用シフトデータBVは出力されない。その2つの蓄積期間が終了後のVALID期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが出力され電荷が読み出される。以下、同様な動作が繰り返される。

[0150]

特に、図16では、シャッタースピードが1フレームを超える場合に、スキャン方向が変更されたとき、読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTが所定のタイミングで読み出しライン用シフトレジスタ5に入力される。なお、上述したように、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTと読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTが、それぞれクリアライン用シフトレジスタ5と読み出しライン用シフトレジスタ5に入力される所定のタイミングとしては、例えばHブランキング期間経過後である。

[0151]

よって、シャッタースピードが1フレームを超える場合、各蓄積期間の開始時に読み出しライン用シフトデータBVが出力されないので、図14から図16のDRNの期間においてダミー読み出しがされない。図14から図16では、クリアライン用シフトレジスタリセット信号VSFRA_RSTのパルス信号の立ち上がりに応じて、クリアライン選択信号VSAのパルス信号は立ち下がり、クリアライン用シフトレジスタ4はリセットされ、読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTのパルス信号の立ち上がりに応じて、読み出しライン選択信号VSBのパルス信号は立ち下がり、読み出しライン用シフトレジスタ5はリセットされる。

[0152]

上述したダミー読み出し及びその禁止は、図17に示す回路によって実現される。図17は、ダミー読み出しの制御を行う回路である。すなわち、フレームレイトの変更、シャッタースピードの変更、間引きフレームの発生、左右スキャン方向の変更、又は上下スキャン方向の変更があると、それらの変更を示す信号が入力される第1のOR回路101と、シャッタースピードが、mHすなわち上記の例では500H以下である状態であることを示す信号とOR回路101の出力とを入力とするAND回路102と、アイドル終了であることを示す信号とAND回路102の出力とを入力とする第2のOR回路103と、第2のOR回路103の出力を入力とする第1の出力回路104と、アイドル終了であることを示す信号と上下スキャン方向の変更を示す信号を入力とする第3のOR回路105とに、第3のOR回路105の出力信号を入力とする第2の出力回路106とを用いることに

10

20

30

30

40

50

よって、ダミー読み出し及びその禁止の処理を実現することができる。

[0 1 5 3]

上記のa)は、第2のOR回路103ヘアイドル終了の状態になると信号が入力される。さらに、上記のb)からe)の条件の一部であるシャッタースピードが500H以下であると、AND回路102の一方の入力端に、シャッタースピードが500H以下であることを示す信号が入力される。また、上記のb)からe)の条件の他の一部である、フレームレイトの変更、シャッタースピードの変更、間引きフレームの発生、左右スキャン方向の変更、又は上下スキャン方向の変更があると、OR回路101にそれらの変更を示す信号が入力され、OR回路101は、AND回路102の一方の入力端に出力信号を出力する。AND回路102の他方の入力端にも、信号が入力されので、AND回路102は2つの入力信号を受信して、OR回路103へ出力信号を出力する。

[0 1 5 4]

従って、上記のa)からe)の条件において、出力回路104から、読み出しライン用シフトデータBVの信号が上述した所定のタイミングで出力される。

また、シャッタースピードがm H すなわち上記の例では 5 0 0 H を超えると、 A N D 回路 1 0 2 の一方に信号が入力されなくなるため、 A N D 回路 1 0 2 から出力信号は出力されない。従って、上述した f)から h)の条件において、ダミー読み出しが禁止される。

[0 1 5 5]

さらに、上下スキャン方向の変更か、アイドル終了があると、その変更あるいは状態を示す、第3のOR回路105の出力信号が、出力回路106への入力信号となるので、上述したタイミングで出力回路106から読み出しライン用シフトレジスタリセット信号VSFRB_RSTが出力される。

従って、ダミー読み出しの禁止が行われ、無駄な画像が生じないので、固体撮像素子からの画像出力を遅れることなく、確実に得ることができる。

[0156]

なお、図17に示す回路は、TG13内に設けられるが、上述したように、HDLを利用 した設計システムを用いれば、別な回路構成で実現される場合もある。

尚、上記実施の形態は、固体撮像素子として閾値電圧変調方式のMOS型イメージセンサを例に説明したが、閾値電圧変調方式のMOS型イメージセンサに限定されるものではなく、他の方式のイメージセンサについても適応可能であることは言うまでも無い。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施の形態に係わる画像処理装置の構成を示すプロック図。
- 【図2】本発明の実施の形態に係わるイメージセンサLSIの構成を示す回路図。
- 【図3】ドレイン・ゲート電圧供給回路の構成を示す回路図。
- 【図4】ソース電圧供給回路の構成を示す回路図。
- 【図5】センサセルへ印加するバイアス電圧を説明するための図。
- 【図6】センサの読み出しラインとクリアラインを説明するための図。
- 【図7】垂直同期信号と水平同期信号のタイミングを示すタイミングチャート。
- 【図8】イメージセンサLSIのタイミングジェネレータの回路ブロック図。
- 【図9】 H ブランキング期間における各信号のタイミングチャート。
- 【図10】アイドル期間終了後のダミー読み出しを示すタイミングチャート。
- 【図11】フレームレイト変更後のダミー読み出しを示すタイミングチャート。
- 【図12】シャッタースピード変更後のダミー読み出しを示すタイミングチャート。
- 【図13】上下、あるいは左右スキャン方向の変更後のダミー読み出しを示すタイミング チャート。
- 【図14】フレームレイト変更後、ダミー読み出しが禁止される場合を説明するためのタ イミングチャート。
- 【図15】シャッタースピード変更後、ダミー読み出しが禁止される場合を説明するためのタイミングチャート。
- 【図16】上下、あるいは左右スキャン方向の変更後、ダミー読み出しが禁止される場合

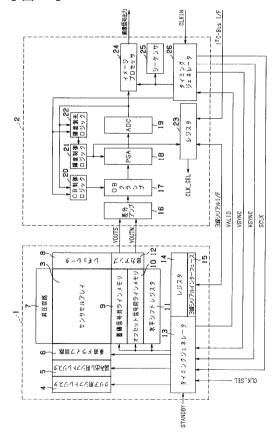
を説明するためのタイミングチャート。

【図17】ダミー読み出しの制御を行う回路。

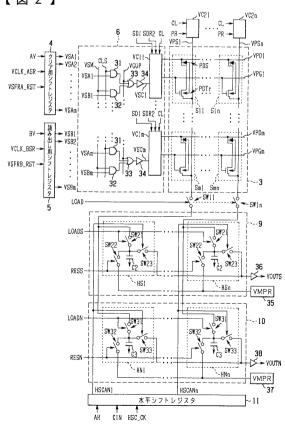
【符号の説明】

1 イメージセンサLSI、 2 信号処理LSI、 3 センサセルアレイ、 6 垂直ドライブ回路、 9 蓄積信号用ラインメモリ、 1 0 オフセット信号用ラインメモリ、 1 3 タイミングジェネレータ

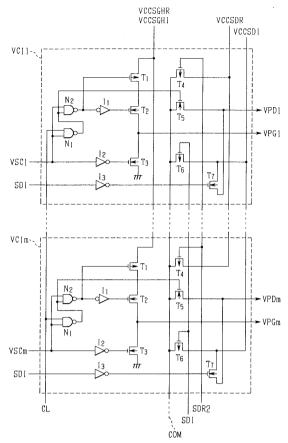
【図1】



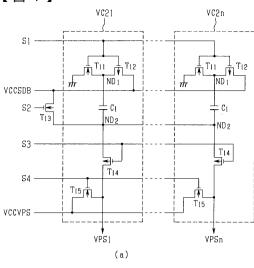
【図2】



【図3】



【図4】

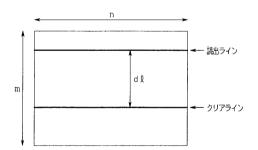




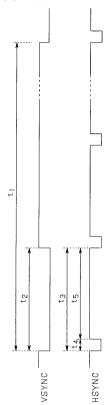
【図5】

センサーバイアス状態	イアス状	32 2						
	状態	蓄積	RESS	LOADS	PR	CL	RESN	LOADN
GATE	選出	VCCSGHI	Lo	VCCSGHR	VCCSGHR	VCCSGHR+ VCCSDB X 2	Lo1	VCCSGHR
	非選択		Lo	Lo	Lo	Γο	2	2
SOURCE	選択	ターンオン (VCCSDI)	VMPR	VCCSGHR-VthS	VCCVPS	VCCSDB×2	VMPR	VCCSGHR-VthN
DRAIN	選択	VCCSDI	HiZ	VCCSDR	ターンオン (VCCVPS)	ターンオン (VCCSDB×2)	HIZ	VCCSDR
	非選択		HiZ	VCCSDR	VCCVPS	VCCSDR	HiZ	VCCSDR

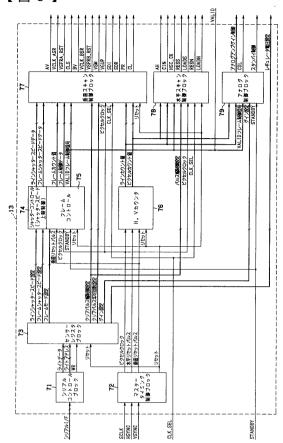
【図6】



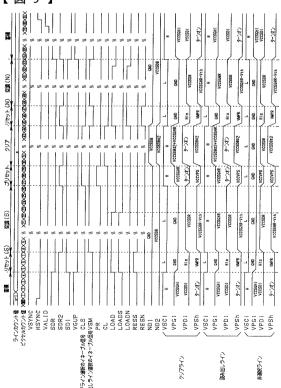
【図7】



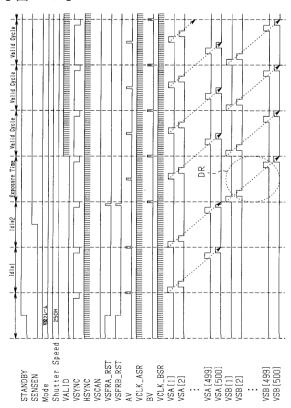
【図8】



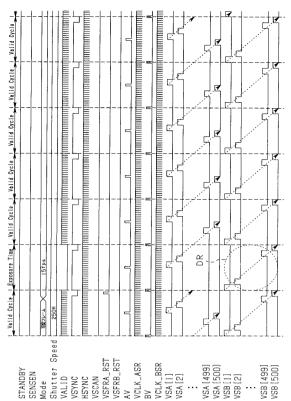
【図9】



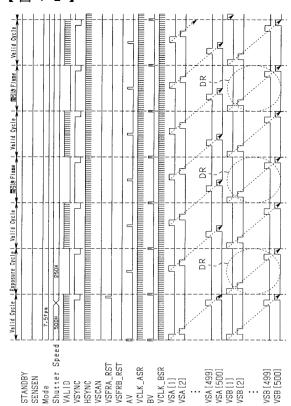
【図10】



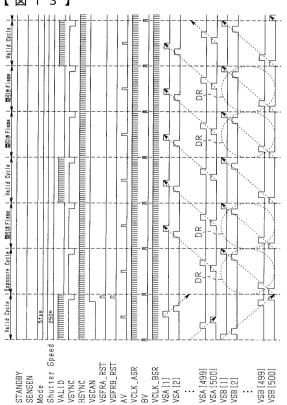




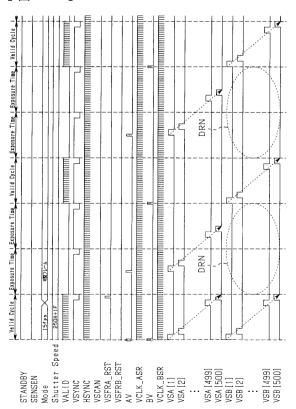
【図12】



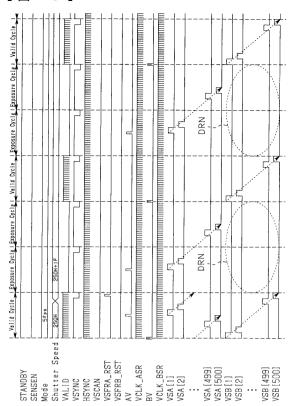
【図13】



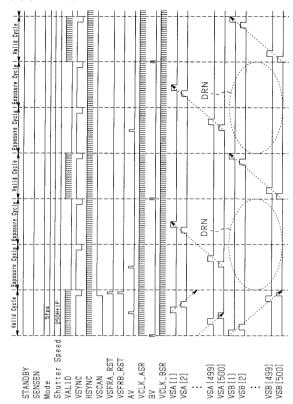
【図14】



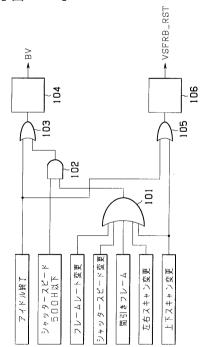




【図16】



【図17】



フロントページの続き

F ターム(参考) 5C051 AA01 BA02 DA06 DB01 DB07 DC02 DC03 DC07 DE02